

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 6月25日

REC'D 0 6 AUG 2004

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-181496

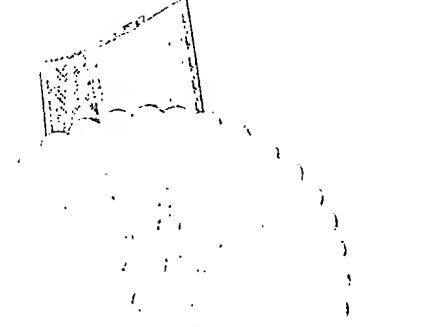
WIPO POT

[ST. 10/C]:

[JP2003-181496]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

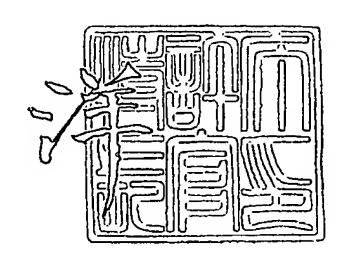


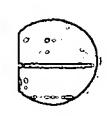
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 7月23日

DO GO





【書類名】

特許願

【整理番号】

2131150072

【提出日】

平成15年 6月25日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G11B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

井村 正春

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式

会社内

【氏名】

田坂 修一

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

110000040

【氏名又は名称】

特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

【代表者】

池内 寛幸

【電話番号】

06-6135-6051

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

139757

〖納付金額〗

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面

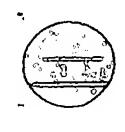
【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0108331



【プルーフの要否】 要



## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学的情報記録再生装置および記録光強度学習方法【特許請求の範囲】

【請求項1】 情報を複数の長さのマークにより記憶する光学的記録媒体と、前記光学的記録媒体に光ビームを照射することによりマークを形成する光照射手段と、

前記光照射手段に対し所望の光強度で発光させる光駆動手段と、

記録するマーク長に応じて記録波形を制御する記録波形制御手段と、

前記光学的記録媒体内の光強度学習領域に所望の光強度でテスト記録を行うよう前記光駆動手段に指令を出す記録出力可変手段と、

テスト記録されたマークに対する再生信号の振幅から変調度を検出する変調度 検出手段と、

テスト記録されたマークに対する再生信号の波形歪みを検出する波形歪み検出 手段と、

前記光強度学習領域に複数の光強度でテスト記録された複数のマークに対する 再生信号の各変調度と許容上限変調度とに基づいて、前記光学的記録媒体への許 容上限変調度に対応した記録光強度を算出する第1の光強度算出手段と、

前記光強度学習領域に複数の光強度でテスト記録された複数のマークに対する 再生信号の各波形歪み量と許容波形歪み量とに基づいて、前記光学的記録媒体へ の許容波形歪み量に対応した記録光強度を算出する第2の光強度算出手段と、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度と前記許容波形歪み量に対応した記録光強度とに基づいて、前記光学的記録媒体に情報を記録する際の光強度範囲を決定する許容光強度範囲決定手段と、

前記光強度範囲決定手段により決定された光強度範囲内で最適な記録光強度を決定する最適光強度決定手段とからなる光学的情報記録再生装置。

【請求項2】 前記記録波形制御手段は、第1のマーク長より短いマークの記録に際しては光強度の強い第1の記録光強度を有する記録波形を出力し、前記第1のマーク長以上のマークの記録に際しては記録波形の前端部および後端部については前記第1の記録光強度を有し、記録波形の中間部については前記第1の記



録光強度以下の第2の記録光強度を有する記録波形を出力する請求項1記載の光 学的情報記録再生装置。

【請求項3】 前記記録出力可変手段は、前記第1の記録光強度と前記第2の 記録光強度の比率を一定に維持しつつ、前記第1および第2の記録光強度を可変 設定する請求項2記載の光学的情報記録再生装置。

【請求項4】 前記許容光強度範囲決定手段は、前記許容上限変調度に対応した た光記録強度と前記許容波形歪み量に対応した記録光強度を比較し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、前記許容上限変調度に対応した記録光強度を上限値とし、前記許容波形歪み量に対応した記録光強度を下限値として記録光強度範囲を決定し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合は、前記第1の記録光強度と前記第2の記録光強度の 比率を前記第2の記録光強度を高めるよう変更した比率に変えるよう前記記録出 力可変手段に指令を出す請求項3記載の光学的情報記録再生装置。

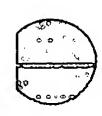
【請求項5】 前記許容光強度範囲決定手段は、前記許容上限変調度に対応した記録光強度と前記許容波形歪み量に対応した記録光強度を比較し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、前記許容上限変調度に対応した記録光強度を上限値とし、前記許容波形歪み量に対応した記録光強度を下限値として記録光強度範囲を決定し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合は、前記第1のマーク長よりも長い第2のマーク長以上の記録波形の中間部の一部に前記第1の光強度を有する記録波形を出力するよう前記記録波形制御手段に指令を出す請求項3記載の光学的情報記録再生装置。

【請求項6】 情報を複数の長さのマークにより記憶する光学的記録媒体と、前記光学的記録媒体に光ビームを照射することによりマークを形成する光照射手段と、

前記光照射手段に対し所望の光強度で発光させる光駆動手段と、



記録するマーク長が第1のマーク長より短いマークの場合は光強度の強い第1 の記録光強度を有する記録波形を出力し、記録するマーク長が前記第1のマーク 長以上のマークの場合は、記録波形の前端部および後端部については前記第1の 記録光強度を有し、記録波形の中間部については前記第1の記録光強度以下の第 2の記録光強度を有する記録波形を出力する記録波形制御手段と、

前記第1の記録光強度を一定に維持し前記第2の記録光強度を可変設定して、 前記光学的記録媒体内の光強度学習領域においてテスト記録を行うよう前記光駆 動手段に指令を出す記録出力可変手段と、

テスト記録されたマークに対する再生信号の振幅から変調度を検出する変調度 検出手段と、

テスト記録されたマークに対する再生信号の波形歪みを検出する波形歪み検出 手段と、

前記光強度学習領域に複数の前記第2の記録光強度でテスト記録された複数のマークに対する再生信号の各変調度と許容上限変調度とに基づいて、前記光学的記録媒体への許容上限変調度に対応した記録光強度を算出する第1の光強度算出手段と、

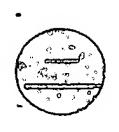
前記光強度学習領域に複数の前記第2の記録光強度でテスト記録された複数のマークに対する再生信号の各波形歪み量と目標波形歪み量とに基づいて、前記光学的記録媒体への目標波形歪み量に対応した記録光強度を算出する第2の光強度 算出手段と、

許容上限変調度に対応した記録光強度と前記目標波形歪み量に対応した記録光強度とに基づいて、前記光学的記録媒体に情報を記録する際の記録波形の各部における記録光強度の比率を決定する光強度比率決定手段と、

前記光強度比率決定手段により決定された記録光強度比率で最適な記録光強度を決定する最適光強度決定手段とからなる光学的情報記録再生装置。

【請求項7】 前記光強度比率決定手段は、前記許容上限変調度に対応した記録光強度と前記目標波形歪み量に対応した記録光強度を比較し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記目標波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、前記目標波形歪み量に対応した記録光強度を用いて

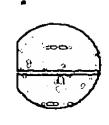


前記記録光強度の比率を決定し、

前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記目標波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合は、前記第1のマーク長よりも長い第2のマーク長以上の記録波形の中間部の一部に前記第1の記録光強度を有する記録波形を出力するよう前記記録波形制御手段に指令を出す請求項6記載の光学的情報記録再生装置。

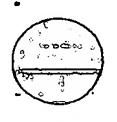
【請求項8】 光強度学習領域を有する光学的記録媒体に光ビームを照射し複数の長さのマークを形成することにより情報を記録し、所定のマーク長以上のマーク形成においては、記録波形の前端部および後端部については光強度の強い第1の記録光強度に設定し、記録波形の中間部については前記第1の記録光強度以下の第2の記録光強度に設定した記録波形で光ビームを照射することによりマークを形成する光学的情報記録再生装置の記録光強度を学習する方法であって、

- (a) 前記第1の記録光強度と前記第2の記録光強度の比率を一定に保ちつつ、前記第1の記録光強度および前記第2の記録光強度をそれぞれ所定の変化量で段階的に変化させ、略最長マークを含む複数のマークからなる光強度学習パターンを前記光強度学習領域に記録するステップと、
- (b) 記録した前記光強度学習パターンにおける複数のマークに対する再生信 号の変調度を検出するステップと、
- (c)記録した前記光強度学習パターンにおける前記略最長マークに対する再生信号の波形歪み量を検出するステップと、
- (d)検出した前記変調度と許容上限変調度とに基づいて、許容上限変調度に対応した記録光強度を求めるステップと、
- (e) 検出した前記波形歪み量と許容波形歪み量とに基づいて、許容歪み量に 対応した記録光強度を求めるステップと、
- (f)前記許容上限変調度に対応した記録光強度と前記許容波形歪み量に対応 した記録光強度を比較するステップと、
- (g) 前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応 した記録光強度よりも小さい場合でかつ前記記録波形の中間部が前記第2の記録 光強度に設定されている場合は、前記中間部の一部を前記第1の記録光強度に設



定するステップと、

- (h) 前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合でかつ前記記録波形の中間部の一部が前記第1の記録光強度に設定されている場合は、前記中間部の一部を時間的に長くするステップと、
- (i)前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記許容波形歪み量に対応 した記録光強度以上である場合は、前記許容上限変調度に対応した記録光強度を 上限値とし、前記許容波形歪み量に対応した記録光強度を下限値として、情報を 記録する際の記録光強度を前記上限値と前記下限値の間に設定するステップとか らなる記録光強度学習方法。
- 【請求項9】 光強度学習領域を有する光学的記録媒体に光ビームを照射し複数の長さのマークを形成することにより情報を記録し、所定のマーク長以上のマーク形成においては、記録波形の前端部および後端部については光強度の強い第1の記録光強度に設定し、記録波形の中間部については前記第1の記録光強度以下の第2の記録光強度に設定した記録波形で光ビームを照射することによりマークを形成する光学的情報記録再生装置の記録光強度を学習する方法であって、
- (a) 前記第1の記録光強度を一定として前記第2の記録光強度を所定の変化量で段階的に変化させ、略最長マークを含む複数のマークからなる光強度学習パターンを前記光強度学習領域に記録するステップと、
- (b) 記録した前記光強度学習パターンにおける複数のマークに対する再生信号の変調度を検出するステップと、
- (c)記録した前記光強度学習パターンにおける前記略最長マークに対する再生信号の波形歪み量を検出するステップと、
- (d)検出した前記変調度と許容上限変調度とに基づいて、許容上限変調度に対応した記録光強度を求めるステップと、
- (e)検出した前記波形歪み量と目標波形歪み量とに基づいて、目標波形歪み量に対応した記録光強度を求めるステップと、
- (f)前記許容上限変調度に対応した記録光強度と前記目標波形歪み量に対応 した記録光強度を比較するステップと、



- (g)前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記目標波形歪み量に対応 した記録光強度よりも小さい場合でかつ前記記録波形の中間部が前記第2の記録 光強度に設定されている場合は、前記中間部の一部を前記第1の記録光強度に設 定するステップと、
- (h)前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記目標波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合でかつ前記記録波形の中間部の一部が前記第1の記録光強度に設定されている場合は、前記中間部の一部を時間的に長くするステップと、
- (i)前記許容上限変調度に対応した記録光強度が前記目標波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、前記目標波形歪み量に対応した記録光強度を第2の記録光強度として設定し、前記第1の記録光強度と設定した前記第2の記録光強度の比率を最適な光強度比率として決定するステップとからなる記録光強度学習方法。

## 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$ 

## 《発明の属する技術分野》

本発明は、光学的記録媒体に対して情報を記録/再生する光学的情報記録再生装置および情報を記録する際の記録光強度を学習する方法に関する。

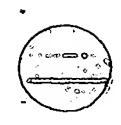
(0002)

### 【従来の技術】

以下、従来の光学的情報記録再生装置および記録光強度学習方法について、図 15から図21を参照して説明する。

[0003]

図15は、従来の光学的情報記録再生装置の構成例を示すブロック図である(例えば、特許文献1参照)。図15において、光学的情報記録再生装置は、光学的記録媒体である光ディスク1と、光ディスク1に光ビームを照射するレーザダイオードを搭載しているピックアップ2と、ピックアップ2内のレーザダイオードを駆動するレーザ駆動回路3と、レーザ駆動回路3に対し所望のレーザ出力を指令するレーザ出力制御回路4と、光ディスク1上に記録されている初期記録パ



ワーを読み出す初期パワー読み込み回路 6 と、読み出された初期記録パワーをもとに記録パワーを可変する記録パワー可変回路 2 0 と、光ディスク 1 上に記録された記録パターンから再生信号の対称性を示すアシンメトリ値を検出するアシンメトリ検出回路 1 8 と、検出されたアシンメトリ値から所望のアシンメトリ値を実現する記録パワーを決定する目標アシンメトリ記録パワー決定回路 1 9 と、光ディスク 1 に記録する記録パターンを発生する記録パターン発生回路 5 とから構成されている。

### (0004)

光ディスク1上には、図16に示すように、情報を記録するデータ領域21以外に、光ディスク1の内周部に、情報の記録に先立って必要に応じて記録パワーを学習する記録パワー学習領域(PCA: Power Calibration Area)22が設けられている。

#### $\{0005\}$

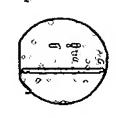
光学的情報記録再生装置が記録パワー学習を行う場合、まず光ディスク1上に記録されている推奨記録パワーおよび目標アシンメトリ値を初期パワー読み込み回路6により読み込む。この推奨記録パワーは一定条件のもとで記録する場合には最適な記録状態が実現できる記録パワーである。目標アシンメトリ値は、最適記録状態時のアシンメトリ値であり、アシンメトリ値と記録状態に一定の相関があることから、記録パワー学習時の指標として用いられる。

#### (0006)

実際に情報を記録する場合には、記録時の温度状態による記録媒体の光感度変化や、ピックアップ2の埃等によるレーザ伝送効率の低下、焦点位置ずれ等の位置決め誤差、チルトずれなどの機械的誤差等により、最適記録パワーがずれるため、記録パワー学習領域22で記録時の状態に応じた最適記録パワーを学習する必要がある。

### [0007]

次に、ピックアップ2を光ディスク1の内周部に設けられた記録パワー学習領域22に移動させ、記録パターン発生回路5から記録パワー学習用パターンを発生させるとともに、初期パワー読み込み回路6により読み込まれた推奨記録パワ



ーを基に、図17に示すように、記録パワー可変回路20により初期記録パワー Pw1から記録パワー増分ΔPwで5段階に記録パワーを可変させ、記録パワー 学習領域22内の一部の範囲である記録パワー学習セクターを用いて記録パワー 学習用パターンを記録する。

[8000]

アシンメトリ検出時には、ピックアップ2からは各記録パワーに応じた再生波 形が再生され、アシンメトリ検出回路18により各記録パワーでのアシンメトリ 値が検出される。

[0009]

図18に、適正な記録パワーで情報が記録された場合の再生波形を示す。記録パワー学習用パターンは、情報を記録する場合と同じ記録パターンで記録されているため、記録単位時間T基準で3T~11Tまでの記録マーク(以後、単にマークと略称する)と未記録スペース(以後、単にスペースと略称する)からなる。

 $\{0010\}$ 

アシンメトリ検出回路18は、再生信号の振幅値Aのうち、最長スペース、最短スペース、最長マーク、最短マークに対するそれぞれの再生信号の振幅値AH1、AH2、AL1、AL2から、以下の式(1)を用いてアシンメトリ値Asを算出する。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$ 

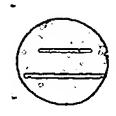
アシンメトリ検出回路18は、記録パワーと検出したアシンメトリ値とに基づいて、図19に示す各記録パワーとアシンメトリ値との関係を求める。

[0012]

目標アシンメトリ記録パワー決定回路19は、記録パワーとアシンメトリ値の関係から、目標アシンメトリ値As\_tを実現する記録パワーPw\_tを決定する。

[0013]





情報をデータ領域21に記録する場合は、記録パワー学習を行って決定された 記録パワーになるようレーザ出力制御回路4が動作し、情報記録時の状態での最 適記録パワーで情報が記録される。

## [0014]

また、近年、高記録密度で高速記録に対応した記録型DVD媒体も普及し、図20に示すような記録パターン波形が複数のパルスで構成されたマルチパルス方式から、図21に示すような記録パターン波形が1つのパルスで構成される非マルチパルス方式へと移行してきている。

### [0015]

たとえば、記録型DVDメディアの高速記録の規格書である「DVD Specifications for Recordable Disc for General Part1 Optional Specifications 4x-SP EED DVD-R」に記録パターン波形が記載されている。

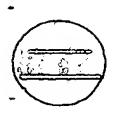
## [0016]

図20は、記録速度の低い場合に使用されるマルチパルス方式で高速記録を行った場合における、記録データ波形、記録パターン波形(以下、記録波形と略称する)、その時のレーザ発光波形、記録されたマーク形状、および再生波形を示す図である。図20から分かるように、レーザ発光に十分な周波数帯域がなくてレーザ光が鈍り、十分な記録発光レベルに達していないため、記録しようとするマークが十分に記録できず、その再生波形も鈍っている。

## [0017]

図21は、非マルチパルスを用いて高速記録を行った場合における、記録データ波形、記録波形、その時のレーザ発光波形、記録されたマーク形状、および再生波形を示す図である。図21から分かるように、レーザ発光に十分な周波数帯域がなくとも記録波形の前端部のパルスを充分長くとることができるため、レーザ発光波形も所定の発光値まで達することができ、また記録波形の後端部に対応するレーザ発光波形も、記録波形の中間部に対応する発光レベルからの立ち上がりでよいため、所定の発光値まで達し、記録されるマークもほぼ所定のマーク形状が形成できる。

[0018]



このときの記録波形の前端部および後端部に対応する記録パワー発光値Poと中間部に対応する記録パワー発光値Pmの比率は、ディスク製造メーカの推奨値としてディスク上に記録されているため、記録装置は、初期パワー読み込み回路6によりその推奨値を取り込み、記録パワー比率 $\epsilon$ ( $\epsilon = Po/Pm$ )で記録波形を形成することができる。

[0019]

【特許文献1】

特表平7-833261号公報

 $\{0020\}$ 

【特許文献2】

特開2002-298358号公報

(0021)

### 【発明が解決しようとする課題】

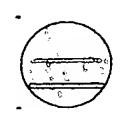
かかる光学的情報記録再生装置においては、ディスク製造メーカの評価装置で使用されている基準装置と実際の記録装置では、ビームスポットの形状やレーザ発光波形の周波数特性などピックアップの特性や、チルト等の機械的なずれや、デフォーカス等の制御ずれなどに起因して、実際の記録波形がずれたり、記録パワーが減少するなどの理由から、ディスク製造メーカの推奨値がそのまま最適記録条件にはならず、各記録装置ごとに最適条件を求める必要がある。

(0022)

特に、非マルチパルス方式による記録では、記録波形の前端部および後端部に対応する記録パワー発光値Poと中間部に対応する記録パワー発光値Pmの比率が適切な比率でないと、長マークの中間部が正常に記録できず、再生波形の中間部が歪み、最悪の場合、マーク長の誤検出が発生して、その結果再生データにエラーが生じる、という問題がある。

[0023]

また、光学的記録媒体は一般的に、最適記録パワーよりも高い記録パワーで記録を行った場合、記録トラック溝を劣化させ、記録トラックと光ビームとの相対位置情報であるトラッキング誤差信号の振幅が減少し、最悪の場合、トラッキン



グ制御が不能になるという場合も発生する。また、トラック溝を劣化させると、たとえばトラック溝に形成された位置情報であるウォブル信号やアドレス情報であるランドプリピットが正常に再生できなくなるため、記録パワーの上限を検出し、その上限記録パワーで記録しないようにする必要がある。

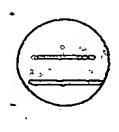
## [0024]

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、トラッキング制御やトラック溝による情報検出が悪化するような高い記録パワーにすることなく、また波形歪みを低減した最適記録条件を決定することができる記録パワー学習を行う光学的情報記録再生装置および記録光強度学習方法を提供することにある。

## [0025]

## 【課題を解決するための手段】

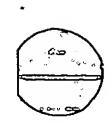
前記の目的を達成するため、本発明に係る光学的情報記録再生装置の第1の態 様は、情報を複数の長さのマークにより記憶する光学的記録媒体(光ディスク) と、光学的記録媒体に光ビームを照射することによりマークを形成する光照射手 段(ピックアップ)と、光照射手段に対し所望の光強度で発光させる光駆動手段 (レーザ駆動回路、レーザ出力制御回路)と、記録するマーク長に応じて記録波 形を制御する記録波形制御手段(記録パターン発生回路)と、光学的記録媒体内 の光強度学習領域に所望の光強度でテスト記録を行うよう光駆動手段に指令を出 す記録出力可変手段(記録パワー可変回路)と、テスト記録されたマークに対す る再生信号の振幅から変調度を検出する変調度検出手段(変調度検出回路)と、 テスト記録されたマークに対する再生信号の波形歪みを検出する波形歪み検出手 段(波形歪み検出回路)と、光強度学習領域(記録パワー学習領域:PCA)に 複数の光強度でテスト記録された複数のマークに対する再生信号の各変調度(m )と許容上限変調度(ms)とに基づいて、光学的記録媒体への許容上限変調度 に対応した記録光強度(Po\_ms)を算出する第1の光強度算出手段(許容変 調度パワー算出回路)と、光強度学習領域に複数の光強度でテスト記録された複 数のマークに対する再生信号の各波形歪み量( $\zeta$ )と許容波形歪み量( $\zeta$ s)と に基づいて、光学的記録媒体への許容波形歪み量に対応した記録光強度 (Po\_



くs)を算出する第2の光強度算出手段(許容波形歪みパワー算出回路)と、許容上限変調度に対応した記録光強度と許容波形歪み量に対応した記録光強度とに基づいて、光学的記録媒体に情報を記録する際の光強度範囲(Po\_ζs~Po\_ms)を決定する許容光強度範囲決定手段(許容パワー範囲決定回路)と、光強度範囲決定手段により決定された光強度範囲内で最適な記録光強度を決定する最適光強度決定手段(最適記録パワー決定回路)とを含む。

[0026]

前記の目的を達成するため、本発明に係る光学的情報記録再生装置の第2の態 様は、情報を複数の長さのマークにより記憶する光学的記録媒体(光ディスク) と、光学的記録媒体に光ビームを照射することによりマークを形成する光照射手 段(ピックアップ)と、光照射手段に対し所望の光強度で発光させる光駆動手段 (レーザ駆動回路、レーザ出力制御回路)と、記録するマーク長が第1のマーク 長(例えば、5T)より短いマークの場合は光強度の強い第1の記録光強度 (P o)を有する記録波形を出力し、記録するマーク長が第1のマーク長以上のマー クの場合は、記録波形の前端部および後端部については第1の記録光強度を有し 、記録波形の中間部については第1の記録光強度以下の第2の記録光強度(Pm )を有する記録波形を出力する記録波形制御手段(記録パターン発生回路)と、 第1の記録光強度を一定に維持し第2の記録光強度を可変設定して、光学的記録 媒体内の光強度学習領域(記録パワー学習領域:PCA)においてテスト記録を 行うよう光駆動手段に指令を出す記録出力可変手段(中間部記録パワー可変回路 )と、テスト記録されたマークに対する再生信号の振幅から変調度を検出する変 調度検出手段(変調度検出回路)と、テスト記録されたマークに対する再生信号 の波形歪みを検出する波形歪み検出手段(波形歪み検出回路)と、光強度学習領 域に複数の第2の記録光強度でテスト記録された複数のマークに対する再生信号 の各変調度(m)と許容上限変調度(ms)とに基づいて、光学的記録媒体への 許容上限変調度に対応した記録光強度(Pm\_ms)を算出する第1の光強度算 出手段(許容変調度パワー算出回路)と、光強度学習領域に複数の第2の記録光 強度でテスト記録された複数のマークに対する再生信号の各波形歪み量(ζ)と 目標波形歪み量(ζt)とに基づいて、光学的記録媒体に対する目標波形歪み量



に対応した記録光強度 (Pm\_ζt) を算出する第2の光強度算出手段と、許容上限変調度に対応した記録光強度と目標波形歪み量に対応した記録光強度とに基づいて、光学的記録媒体に情報を記録する際の記録波形の各部における記録光強度の比率 (Po/Pm\_ζt) を決定する光強度比率決定手段 (記録パワー比決定回路) と、光強度比率決定手段により決定された記録光強度比率で最適な記録光強度を決定する最適光強度決定手段 (最適記録パワー決定回路) とを含む。

[0027]

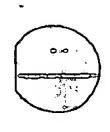
前記の目的を達成するため、本発明に係る記録光強度学習方法の第1の態様は 、光強度学習領域(記録パワー学習領域:PCA)を有する光学的記録媒体(光 ディスク)に光ビームを照射し複数の長さのマークを形成することにより情報を 記録し、所定のマーク長(例えば、5T)以上のマーク形成においては、記録波 形の前端部および後端部については光強度の強い第1の記録光強度(Po)に設 定し、記録波形の中間部については第1の記録光強度以下の第2の記録光強度( Pm)に設定した記録波形で光ビームを照射することによりマークを形成する光 学的情報記録再生装置の記録光強度を学習する方法であって、(a)第1の記録 光強度と第2の記録光強度の比率(Po/Pm)を一定に保ちつつ、第1の記録 光強度および第2の記録光強度をそれぞれ所定の変化量(ΔPo、ΔPm)で段 階的に変化させ、略最長マーク(例えば、11Tマーク)を含む複数のマーク( 3 T~11T) からなる光強度学習パターンを光強度学習領域に記録するステッ プと、(b)記録した光強度学習パターンにおける複数のマークに対する再生信 号の変調度を検出するステップと、(c)記録した光強度学習パターンにおける 最長マークに対する再生信号の波形歪み量を検出するステップと、(d)検出し た変調度(m)と許容上限変調度(ms)とに基づいて、許容上限変調度に対応 した記録光強度(Po\_ms)を求めるステップと、(e)検出した波形歪み量 (ζ)と許容波形歪み量(ζs)とに基づいて、許容波形歪み量に対応した記録 光強度( $Po_{-} \xi s$ )を求めるステップと、(f)許容上限変調度に対応した記 録光強度と許容波形歪み量に対応した記録光強度を比較するステップと、(g) 許容上限変調度に対応した記録光強度が許容波形歪み量に対応した記録光強度よ りも小さい場合でかつ記録波形の中間部が第2の記録光強度に設定されている場



合は、中間部の一部を第1の記録光強度に設定するステップと、(h)許容上限 変調度に対応した記録光強度が許容波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さ い場合でかつ記録波形の中間部の一部が第1の記録光強度に設定されている場合 は、中間部の一部を時間的に長くするステップと、(i)許容上限変調度に対応 した記録光強度が許容波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、許容 上限変調度に対応した記録光強度を上限値とし、許容波形歪み量に対応した記録 光強度を下限値として、情報を記録する際の記録光強度を上限値と下限値の間に 設定するステップとを含む。

[0028]

前記の目的を達成するため、本発明に係る記録光強度学習方法の第2の態様は 、光強度学習領域(記録パワー学習領域:PCA)を有する光学的記録媒体(光 ディスク)に光ビームを照射し複数の長さのマークを形成することにより情報を 記録し、所定のマーク長(例えば、5T)以上のマーク形成においては、記録波 形の前端部および後端部については光強度の強い第1の記録光強度(Po)に設 定し、記録波形の中間部については第1の記録光強度以下の第2の記録光強度( Pm)に設定した記録波形で光ビームを照射することによりマークを形成する光 学的情報記録再生装置の記録光強度を学習する方法であって、(a)第1の記録 光強度を一定として第2の記録光強度を所定の変化量(ΔPm)で段階的に変化 させ、略最長マーク(例えば、11Tマーク)を含む複数のマーク(3T~11 T)からなる光強度学習パターンを光強度学習領域に記録するステップと、(b )記録した光強度学習パターンにおける複数のマークに対する再生信号の変調度 を検出するステップと、(c)記録した光強度学習パターンにおける略最長マー クに対する再生信号の波形歪み量を検出するステップと、(d)検出した変調度 (m)と許容上限変調度(ms)とに基づいて、許容上限変調度に対応した記録 光強度 ( $Pm_ms$ ) を求めるステップと、(e) 検出した波形歪み量 ( $\zeta$ ) と 目標波形歪み量(ζt)とに基づいて、目標波形歪み量に対応した記録光強度( Pm\_ζt)を求めるステップと、(f)許容上限変調度に対応した記録光強度 と目標波形歪み量に対応した記録光強度を比較するステップと、(g)許容上限 変調度に対応した記録光強度が目標波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さ



い場合でかつ記録波形の中間部が第2の記録光強度に設定されている場合は、中間部の一部を第1の記録光強度に設定するステップと、(h)許容上限変調度に対応した記録光強度が目標波形歪み量に対応した記録光強度よりも小さい場合でかつ記録波形の中間部の一部が第1の記録光強度に設定されている場合は、中間部の一部を時間的に長くするステップと、(i)許容上限変調度に対応した記録光強度が目標波形歪み量に対応した記録光強度以上である場合は、目標波形歪み量に対応した記録光強度として設定し、第1の記録光強度と設定した第2の記録光強度の比率(Po/Pm\_ζt)を最適な光強度比率として決定するステップとを含む。

RO0297

《発明の実施の形態》

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

 $\{0030\}$ 

(実施の形態1)

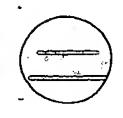
図1は、本発明の実施の形態1に係る光学的情報記録再生装置の一構成例を示すブロック図である。図1において、1は光学的記録媒体としての光ディスクで、情報を記録する記録トラック溝が形成されており、また光ディスク1の内周部には、図16に示すように、光強度学習領域としての記録パワー学習領域(PCA)22が設けられている。2は光照射手段としてのピックアップであり、光ディスク1に光ビームを照射するレーザダイオードを搭載している。3はレーザダイオードを駆動するレーザ駆動回路、4はレーザ駆動回路3を用いてレーザダイオードの出力を制御するレーザ出力制御回路3なり、レーザ駆動回路3およびレーザ出力制御回路4は光駆動手段を構成する。

 $\{0031\}$ 

5は記録波形制御手段としての記録パターン発生回路であり、レーザダイオードの発光波形を制御する。6は光ディスク1上に記録されている初期記録情報を読み出す初期記録情報読み込み回路である。

[0032]

7は変調度検出手段としての変調度検出回路であり、再生信号の振幅から変調



度(m)を検出する。8は第1の光強度算出手段としての許容変調度パワー算出 回路であり、変調度検出回路7により検出された変調度mと許容上限変調度(m s)とに基づいて、許容上限変調度msに対応した記録パワー(Po\_ms)を 算出する。

[0033]

9は波形歪み検出手段としての波形歪み検出回路であり、略最長マーク(例えば、11 Tマーク)に対する再生信号の波形歪み量( $\zeta$ )を検出する。10 は第2 の光強度算出手段としての許容波形歪みパワー算出回路であり、波形歪み検出回路 9 により検出された波形歪み量  $\zeta$  と許容波形歪み量( $\zeta$  s)とに基づいて、許容波形歪み量  $\zeta$  s に対応した記録パワー( $\zeta$  s)を算出する。

[0034]

11は許容光強度範囲決定手段としての許容パワー範囲決定回路であり、許容変調度パワー算出回路8により算出された記録パワーPo\_msと、許容波形歪みパワー算出回路10により算出された記録パワーPo\_なsとに基づいて、光ディスク1に情報を記録する最の記録パワーの範囲を決定する。

[0035]

12は記録出力可変手段としての記録パワー可変回路であり、記録パワー学習 領域で記録パワー学習を行う際に、レーザ出力制御回路4に対し記録パワーを可 変設定するよう指令する。

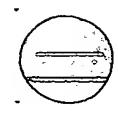
[0036]

13は最適記録光強度決定手段としての最適記録パワー決定回路であり、許容パワー範囲決定回路12により決定された記録パワー範囲や他の情報をもとに、最終的に情報を記録するための最適記録パワーを決定する。

[0037]

14は切換スイッチであり、記録パワー学習を行う場合は、記録パワー可変回路12からの指令がレーザ出力制御回路4に供給されるように接点をA側に切り換え、通常の情報記録時には、最適記録パワー決定回路13からの指令がレーザ出力制御回路4に供給されるように接点をB側に切り換える。

[0038]



次に、以上のように構成された光学的情報記録再生装置における記録パワー学習方法について、図1に加えて、図2を参照して説明する。図2は、本実施の形態よる記録光強度学習方法における手順を示すフローチャートである。

[0039]

光学的情報記録再生装置が記録パワー学習を行う場合、まず光ディスク1上に記録されている初期記録情報である推奨記録パワーPoi、推奨記録パワー比  $\varepsilon$  i、推奨記録発光波形等を初期記録情報読み込み回路 6 により読み込む(S 2 0 1)。

 $\{0040\}$ 

[0041]

次に、ピックアップ2を光ディスク1の内周部に設けられた記録パワー学習領域22(図16)に移動させる(S203)。

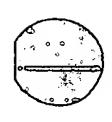
[0042]

(ステップS204)

記録パターン発生回路 5 は、記録パワー学習用記録データとして、たとえばランダムな8-16エンコードデータを受け、3 T~11T (Tはクロック周期を表す) および14 T長マークを記録するため、3 Tおよび4 Tマークについては記録パワーの強い第1の記録パワーPoで、5 Tマーク長以上のマークについては前端部および後端部は記録パワーの強い第1の記録パワーPoで、中間部は第1の記録パワーPo以下の第2の記録パワーPmでレーザーダイオードを発光させるための記録パターン(光強度学習パターン)を出力する。

[0043]

記録パワー可変回路 12 は、初期記録情報読み込み回路 6 からのパワー学習用設定値に基づき、第 1 の記録パワー P o と第 2 の記録パワー P m との比である記録パワー比  $\epsilon$  を一定に維持しながら、第 1 の記録パワー P o および第 2 の記録パ



ワーPmのそれぞれの初期記録パワーPol、Pmlをレーザ出力制御回路4に送る。また、記録パワー可変回路12は、記録パワーを可変して記録するための記録パワー増分量 $\Delta$ Po、 $\Delta$ Pmをもとに、以降の記録パワー(Po2, Pm2)、(Po3, Pm3)、…(Po(i), Pm(i)(i=1、2、3、…))を求め、切換スイッチ14を介してレーザ出力制御回路4に送る。

#### [0044]

レーザ出力制御回路 4 は、記録パワー可変回路 1 2 からの指令に基づいて、レーザ駆動回路 3 にレーザダイオードを発光するよう指令する。そして記録パワー学習領域内の所定の領域で記録パワー P o 1 、 P m 1 でパワー学習用記録データ記録する。その次に、記録パワーを $\Delta$  P o 、 $\Delta$  P m 2 で 別の記録パワー学習領域にパワー学習用記録データを記録する。この操作を所定の回数、例えば 6 回繰り返し、記録パワー学習用記録データを記録する。以上がステップ S 2 0 4 での処理である。

### [0045]

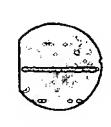
記録パワー学習用記録データの再生時(S205)には、変調度検出回路7がそれぞれの記録パワーで記録したマークに対する再生信号の変調度mを検出する(S206)。ここで、図3および図4を参照して、記録パワーと変調度との関係を説明する。

## [0046]

図3は、正常に記録された場合における、記録パターン発生回路5に入力される記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、記録パターン発生回路5およびレーザ出力制御回路4からの指令を受けてレーザ駆動回路3が出力するレーザ駆動信号波形(b)、光ディスク1に記録された11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの再生波形(d)を示す図である。図3から分かるように、適正な記録パワーおよび記録パワー比で記録された記録マークの変調度は正常で、記録マークによるトラック溝の劣化を起こしていない。

### [0047]

図4は、記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmがともに大きな場合について、各波形および記録マークを示している。この場合、記録され



0

た11T記録マークの幅が太くなるため、変調度が大きくなるとともに、記録マークがトラック溝を覆いトラック溝形状を壊すようになる。

### [0048]

そこで、許容変調度パワー算出回路8は、記録パワーPo1からPo6で記録された記録マークに対する再生信号の変調度と許容上限変調度msとに基づいて、許容上限変調度msに対応した記録パワーPo\_msを算出する(S207)

### [0049]

ここで、許容上限変調度msとは、光学的情報記録再生装置において、記録された記録マークが記録過剰状態になると、図4に示すようにトラック溝形状を劣化させて、例えばトラッキングエラー信号が正常に検出できなくなることなどが発生することを防ぐため、再生時の変調度で判定する変調度の基準値である。

#### [0050]

また、パワー学習用記録データの再生時(S205)には、波形歪み検出回路 9が、たとえば11 T長マークに対する再生信号の波形歪み量  $\xi$  を検出する(S208)。ここで、図3 および図5 を参照して、記録パワーと波形歪み量  $\xi$  との 関係を説明する。

#### $\{0051\}$

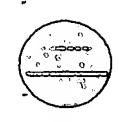
図3は、前述したように正常に記録された場合で、適正な記録パワーおよび記録パワー比で記録された記録マークの記録幅は一定であり、再生波形の中間部も平らで波形歪みを起こしていない。

### [0052]

図5は、記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmがともに小さい場合を示している。この場合、記録された11T記録マークの前端部および後端部に比べ中間部の記録幅が細くなり、再生波形の中間部が明側に歪んだ波形となる。

### [0053]

波形歪み検出回路9は、たとえば11T記録マークの再生波形の場合、基準再生クロックでサンプルされた12個の検出値(図5のS0~S11)の最小値(



S 1 0)と中間部の極大値(S 6)、および非マーク部の検出値(S 1 4)に基づいて波形歪み量 $\zeta$ を算出する。図 5 においては、1 1 T記録マークに対する再生波形の最小値はS 1 0 であり、中間部の極大値はS 6、非マーク部の検出値はS 1 4 であるので、波形歪み量 $\zeta$ は、 $\zeta$  = (S 6 - S 1 0) / (S 1 4 - S 1 0 ) として求められる。

### [0054]

許容波形歪みパワー算出回路 10 は、記録パワーPo1からPo6での波形歪み量と許容波形歪み量  $\zeta$  s とに基づいて、許容波形歪み量  $\zeta$  s に対応した記録パワー $Po_{\zeta}$  s を算出する(S209)。

## (0055)

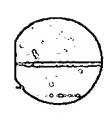
ここで、許容波形歪み量なsとは、光学的情報記録再生装置において、記録された記録マークが記録不足状態になると、図5に示すように再生波形の中間部の振幅が減少し、最悪の場合、非マークとして検出する可能性があり、これを防ぐため、再生時の波形歪み量で判定する波形歪み量の基準値である。

## [0056]

図6は、記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmを変化させた場合における、変調度m、波形歪み量なおよび許容上限変調度ms、許容波形歪み量な<math>sの関係を示すグラフである。図sにおいて、記録パワーs0をs0 をs0 をs0 の再生信号の各記録パワーでの変調度と許容上限変調度s0 とに基づいて、許容変調度パワー算出回路s1 は、許容上限変調度s2 に基づいて、許容波形歪み、各記録パワーでの波形歪み量と許容波形歪み量なs3 とに基づいて、許容波形歪みパワー

## [0057]

許容パワー範囲決定回路11は、許容される変調度範囲としては許容上限変調度ms以下の範囲で、許容される波形歪み範囲としては許容波形歪み量  $\xi$  s 以下の範囲であるため(図2のS210における判断でYes)、許容記録パワー範囲を許容波形歪み量  $\xi$  s に対応した記録パワーPo\_ $\xi$  s 以上でかつ許容上限変調度msに対応した記録パワーPo\_ms以下の範囲に決定する(S211)。



なお、本明細書での説明では省略しているが、変調度の下限値は規格書等に規定されており、もし許容下限変調度に対応した記録パワーが許容波形歪み量 $\xi$ sに対応した記録パワーPo\_ $\xi$ sよりも大きな場合は、許容記録パワー範囲の下限値は、許容下限変調度に対応した記録パワーに決定される。

(0058)

許容パワー範囲決定回路11で決定された許容記録パワー範囲に基づいて、最適記録パワー決定回路13は情報を記録する最適記録パワーPwを決定する(S212)。最適記録パワーPwは、許容記録パワー範囲の内、例えばジッタ値がもっとも低い記録パワーを選択することにより決定される。

[0059]

最適記録パワー決定回路13で決められた最適記録パワーPwが、データ領域21(図16)に情報を記録する記録パワーとしてレーザ出力制御回路4に送られ情報が記録される。

[0060]

ここで、光学的情報記録再生装置によっては、光ディスク1とピックアップ2 の特性差に起因して、許容記録パワー範囲が求められない場合が発生する。

(0061)

図7は、図6と同様、記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmを変化させた場合における、変調度m、波形歪み量 $\xi$  (点線) および許容上限変調度m s、許容波形歪み量 $\xi$  s の関係を示したグラフである。図7から分かるように、許容上限変調度m s に対応した記録パワー $po_m$  s が許容波形歪み量 $\xi$  s に対応した記録パワー $po_m$  s が許容波形歪み量ける判断で $po_k$  s のよりも小さくなり(図2のS210における判断で $po_k$  s の、許容記録パワー範囲が決定できない。

[0062]

このような場合、許容パワー範囲決定回路11は、記録パターン発生回路5に対し、例えば9Tマーク長以上のマークに対しては中間部の一部に第1の記録パワーの波形(中間パルス)を出力するように指令する(S213の判断でNoにより分岐したS214)。

[0063]

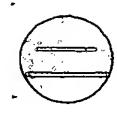


図8は、11T記録パターンの中間部の一部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを出した場合における、記録データ波形(a)、レーザ駆動信号(b)、記録された11T記録マークの形状(c)、11T記録マークに対する再生波形(d)を示す概略図である。図8において、記録パターンの中間部の一部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成したことにより、記録マークの中間部の幅が太くなり、図5と比較して再生信号の波形歪みが改善されることが分かる。

[0064]

図7において、記録マークの中間部の一部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成したことにより、同一のPo、Pmの値で波形歪み量が少なくなる(実線)ため、許容波形歪み量 $\zeta$ sに対応した記録パワーPo\_ $\zeta$ s 1が小さくなり、許容記録パワー範囲を決定することができる。

[0065]

また、この記録マークの中間部の一部に生成する第1の記録パワーを有する中間パルスの幅を徐々に大きくする(図2のS213の判断でYesにより分岐したS215)ことにより、波形歪みを徐々に改善できるので、一度この中間パルスを生成しても、まだ許容記録パワー範囲が決定できない場合には、この中間パルスの幅を大きくして、再度記録パワー学習をする(S204に戻る)ことにより、許容記録パワー範囲を求めることができる。

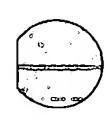
[0066]

なお、以上の説明では、許容変調度パワー算出回路、波形歪みパワー算出回路、許容パワー範囲決定回路、最適記録パワー決定回路等といった回路構成として説明したが、これらと同等のことを例えばマイクロコンピュータ等の演算で行わせても同様な結果になることは言うまでもない。

[0067]

(実施の形態2)

図9は、本発明の実施の形態2に係る光学的情報記録再生装置の一構成例を示すブロック図である。なお、図9において、実施の形態1で参照した図1と同じ部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。以下では主に、実施



形態1との相違点について説明する。

(0068)

図9において、110は第2の光強度算出手段としての目標波形歪みパワー比算出回路であり、波形歪み検出回路9により検出された再生信号の波形歪みなと目標波形歪み量なtとに基づいて、目標波形歪み量なtに対応した記録パワーPm\_なtを算出する。

[0069]

111は光強度比決定手段としての記録パワー比決定回路であり、許容変調度パワー算出回路8により算出された許容上限変調度msに対応した記録パワーアm\_msと目標波形歪み量 ζ t に対応した記録パワーアm\_\_ ζ t とに基づいて、記録パワー比Po/Pm ζ を決定する。

 $\{0070\}$ 

112は記録出力可変手段としての中間部記録パワー可変回路であり、記録パワー学習領域で記録パワー学習を行う際に、レーザ出力制御回路4に対し、所定のマーク長以上のマーク形成においては、記録波形の前端部および後端部については記録パワーの強い第1の記録パワーPoでレーザビームを照射し、中間部については第1の記録パワー以下の第2の記録パワーPmでレーザビームを照射するとともに、中間部の記録パワーPmを段階的に可変設定するようレーザ出力制御回路4に指令する。

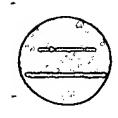
{{0 0 7 1}

次に、以上のように構成された光学的情報記録再生装置における記録パワー学習方法について、図9に加えて、図10を参照して説明する。図10は、本実施の形態よる記録光強度学習方法における手順を示すフローチャートである。

[0072]

光学的情報記録再生装置が記録パワー学習を行う場合、実施の形態1と同様に、まず光ディスク1上に記録されている初期記録情報である推奨記録パワーPoi、推奨記録パワー比 ε i、推奨記録発光波形等を初期記録情報読み込み回路6により読み込む(S201)。

[0073]



また、初期記録情報読み込み回路 6 は、読み込んだ推奨値に基づいて、最適な記録パワーを求めるための第1の記録パワーPo、第2の記録パワーPm、第2の記録パワー増分 Δ Pm、記録パワー学習用記録パターン波形を、記録パターン発生回路 5 および中間部記録パワー可変回路 1 1 2 に送り設定する(S 3 0 2)。

[0074]

次に、ピックアップ2を光ディスク1の内周部に設けられた記録パワー学習領域22(図16)に移動させる(S203)。

[0075]

(ステップS304)

記録パターン発生回路 5 は、記録パワー学習用記録データとしてたとえばランダムな8-16エンコードデータを受けて、3 T~11 Tおよび14 T長マークを記録するため、3 Tおよび4 Tマークについては記録パワーの強い第1の記録パワーPoで、5 Tマーク長以上のマークについては前端部および後端部は記録パワーの強い第1の記録パワーPoで、中間部は第1の記録パワーPo以下の第2の記録パワーPmでレーザダイオードを発光させるための記録パワー学習用記録パターンを出力する。

[0076]

[0077]

レーザ出力制御回路 4 は、中間部記録パワー可変回路 1 7 からの指令に基づいて、記録パターンの前端部および後端部においては光強度の強い第 1 の記録パワーPoを、中間部では第 2 の記録パワーPmとなるようレーザ駆動回路 3 に指令を送る。そして記録パワー学習領域内の所定の領域に、第 1 の記録パワーPo、第 2 の記録パワーPm 1 でパワー学習用記録データを記録する。その次に、第 1



の記録パワーΡο、第2の記録パワーΡm1をΔPm増分させたPm2で、記録パワー学習領域内の別の箇所にパワー学習用記録データを記録する。この操作を所定の回数、例えば6回繰り返し、パワー学習用記録データを記録する。以上がステップS304での処理である。

[OO78]

パワー学習用記録データの再生時(S 2 0 5)には、実施の形態1と同様に、変調度検出回路7が、第1の記録パワーPo、複数の第2の記録パワーPm1~Pm6で記録されたマークに対する再生信号の変調度mを検出する(S 3 0 6)。許容変調度パワー算出回路8は、複数の第2の記録パワーPm1~Pm6で記録された記録マークに対する再生信号の変調度と許容上限変調度msとに基づいて、許容上限変調度msに対応した記録パワーPm\_msを算出する(S 3 0 7)。

[0079]

また、パワー学習用記録データの再生時(S205)には、波形歪み検出回路 9が、たとえば11 T長マークに対する再生信号の波形歪み量 $\xi$ を検出する(S308)。ここで、図11 および図12 を参照して、記録パワー比と波形歪みとの関係を説明する。

[0080]

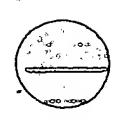
図11は、記録パワー比Po/Pmが大きくて、第2の記録パワーPmが小さい場合における各波形および記録マークを示している。この場合、記録された11で記録マークの前端部および後端部に比べて中間部の記録幅が細くなり、再生波形の中間部が明側に歪んだ波形となる。

(0081)

図12は、記録パワー比Po/Pmが小さくて、第2の記録パワーPmが大きい場合における各波形および記録マークを示している。この場合、記録された11で記録マークの前端部および後端部に比べて中間部の記録幅が太くなり、再生波形の中間部が暗側に歪んだ波形となる。

[0082]

そこで、目標波形歪みパワー比算出回路15は、第2記録パワーPm1からP



m6で記録された11Tマークに対する再生信号の波形歪み量と目標波形歪み量  $\xi$ tとに基づいて、目標波形歪み量  $\xi$ tに対応した記録パワーPm\_ $\xi$ tを算出する(図10 $\theta$ S309)。

(0083)

ここで、目標波形歪み量 ξ t とは、光学的情報記録再生装置において、記録された記録マークが記録過不足状態になると、図11および図12に示すように、再生波形の中間部の振幅が減少した場合は、非マークとして検出する可能性が発生し、再生波形の中間部の振幅が増加しすぎると、記録マークがトラック溝を覆いトラック溝形状を壊すようになることを防ぐため、再生時の適正な波形歪み量で判定する波形歪み量の基準値である。

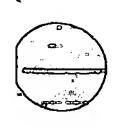
(0084)

図13は、第1の記録パワーPoを一定に維持して第2の記録パワーPmを変化させた場合における、変調度m、波形歪み量 ζ および許容上限変調度m s、目標波形歪み量 ζ t の関係を示すグラフである。記録パワーPmをPm1からPm6と変化させて記録した記録パワー学習用記録データに対する再生信号に対して、各記録パワーでの変調度と許容上限変調度m s とに基づいて、許容変調度パワー算出回路 8 は、許容上限変調度に対応した記録パワーPm\_m s を求め、各記録パワーでの波形歪み量と目標波形歪み量 ζ t とに基づいて、目標波形歪みパワー算出回路 1 0 は、目標波形歪み量 ζ t に対応した記録パワーPm\_ζ t を求める。

[0085]

[0086]

記録パワー比決定回路16で決定された最適記録パワー比に基づいて、最適記録パワー決定回路13は、情報を記録する際の最適記録パワーPwを決定する。



最適記録パワーPwは、最適記録パワー比 ε\_ζ t を用いて、例えばアシンメトリが所望の値となる記録パワーを選択することにより決定される。

[OO87]

最適記録パワー決定回路13で決められた最適記録パワーPwが、データ領域に情報を記録する記録パワーとしてレーザ出力制御回路4に送られ、情報が記録される。

[8800]

また、光学的情報記録再生装置によっては、光ディスク1とピックアップ2の特性差に起因して最適記録パワー比が求められない場合が発生する。

[0089]

図14は、図13と同様に、第1の記録パワーPoを一定に維持して第2の記録パワーPmを変化させた場合における変調度m、波形歪み量 $\zeta$  (点線) および許容上限変調度ms、目標波形歪み量 $\zeta$  t の関係を示すグラフである。図14から分かるように、許容上限変調度ms に対応した記録パワーPm\_msが目標波形歪み量 $\zeta$  t に対応した記録パワーPm\_ $\zeta$  t 0よりも小さくなり(図10のS310の判断でNo)、最適記録パワー比 $\varepsilon$ \_ $\zeta$  t が決定できない。

[0090]

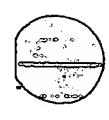
このような場合、記録パワー比決定回路16は、記録パターン発生回路5に対し、例えば9Tマーク長以上のマークに対して、中間部の一部に第1の記録パワーPoを有する波形(中間パルス)を出力するように指令する(図10のS213の判断でNoにより分岐したS214)。

(0091)

図14において、記録マークの中間部の一部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成したことにより、同一のPmの値で波形歪み量が少なくなる(実線)ため、目標波形歪み量 $\xi$ tに対応した記録パワーPm $\xi$ tが小さくなり、このため最適記録パワー比 $\varepsilon$  $\xi$ tを決定することができる。

[0092]

また、この記録マークの中間部の一部に生成する第1の記録パワーPoを有する中間パルスの幅を徐々に大きくする(図10のS213の判断でYesにより



分岐したS215)ことにより、波形歪みを徐々に改善できる。したがって、一度この中間パルスを生成しても、まだ最適記録パワー比  $\epsilon$  \_  $\epsilon$  t が決定できない場合には、中間パルスの幅を大きくして、再度記録パワー学習をする(図10のS304に戻る)ことで、最適記録パワー比  $\epsilon$  \_  $\epsilon$  t を求めることができる。

(0093)

なお、以上の説明では、許容変調度パワー算出回路、目標波形歪みパワー算出 回路、最適パワー比決定回路、最適記録パワー決定回路等といった回路構成とし て説明したが、これらと同等のことを例えばマイクロコンピュータ等の演算で行 わせても同様な結果になることは言うまでもない。

[0094]

### 【発明の効果】

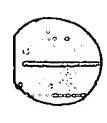
以上説明したように、本発明によれば、記録パワーを決定する記録パワー学習において変調度による上限記録パワーと波形歪み量による下限記録パワーを求め、その間で記録パワーを決定するため、記録パワーが大き過ぎることによるトラック溝の劣化を防ぐとともに波形歪みが発生することがなく、情報記録時の記録パワーを最適化できるという効果が得られる。

[0095]

また、目標波形歪み量に対応した記録パワー比を、記録パワーが大き過ぎることによるトラック溝の劣化が発生しない範囲で決められることにより、情報記録時の記録パワーを最適化できるという効果が得られる。

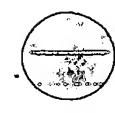
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施の形態1に係る光学的情報記録再生装置の一構成例を 示すブロック図
- 【図2】 本発明の実施の形態1に係る記録光強度学習方法における手順を示すフローチャート
- 【図3】 正常な記録の場合における、記録パワー学習用記録データの11T 波形(a)、レーザ駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、 11T記録マークの再生波形(d)を示す図
  - 【図4】 記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmがともに



大きな場合における、記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、レーザ 駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの 再生波形(d)を示す図

- 【図5】 記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmがともに小さい場合における、記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、レーザ駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの再生波形(d)を示す図
- 【図 6 】 記録パワー比Po/Pmが一定で、記録パワーPo、Pmを変化させた場合における、変調度m、波形歪み量 $\zeta$ および許容上限変調度ms、許容波形歪み量 $\zeta$ sの関係を示すグラフ
- 【図7】 図6に対して、記録パターンの中間部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成した場合における、記録パワーPoと波形歪み量なの関係の変化を示すグラフ
- 【図8】 記録パターンの中間部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成した場合における、記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、レーザ駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの再生波形(d)を示す図
- 【図9】 本発明の実施の形態2に係る光学的情報記録再生装置の一構成例を 示すブロック図
- 【図10】 本発明の実施の形態2に係る記録光強度学習方法における手順を 示すフローチャート
- 【図11】 記録パワー比Po/Pmが大きくて、第2の記録パワーPmが小さい場合における、記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、レーザ駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの再生波形(d)を示す図
- 【図12】 記録パワー比Po/Pmが小さくて、第2の記録パワーPmが大きい場合における、記録パワー学習用記録データの11T波形(a)、レーザ駆動信号波形(b)、11T記録マークの概略形状(c)、11T記録マークの再生波形(d)を示す図



- 【図13】 第1の記録パワーPoを一定に維持して第2の記録パワーPmを変化させた場合における、変調度m、波形歪み量 $\zeta$ および許容上限変調度ms、目標波形歪み量 $\zeta$ t の関係を示すグラフ
- 【図14】 図13に対して、記録パターンの中間部に第1の記録パワーPoを有する中間パルスを生成した場合における、記録パワーPoと波形歪み量 $\xi$ の関係の変化を示すグラフ
  - 【図15】 従来の光学的情報記録再生装置の構成例を示すブロック図
- 【図16】 記録パワー学習領域を有する光ディスクの構造を模式的に示す平面図
- 【図17】 従来の記録パワー学習時における記録パワーの段階的な変化を示す図
- 【図18】 アシンメトリ値を説明するための、適正な記録パワーで情報が記録された場合の再生波形を示す図
- 【図19】 記録パワーPwと再生信号のアシンメトリ値Asとの関係を示すグラフ
- 【図20】 マルチパルス方式で高速記録を行った場合における、記録データ波形、記録パターン波形、レーザ発光波形、記録されたマーク形状、および再生波形を示す図
- 【図21】 非マルチパルス方式で高速記録を行った場合における、記録データ波形、記録波形、その時のレーザ発光波形、記録されたマーク形状、および再生波形を示す図

#### 【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2 ピックアップ
- 3 レーザ駆動回路
- 4 レーザ出力制御回路
- 5 記録パターン発生回路
- 6 初期記録情報読み込み回路
- 7 変調度検出回路



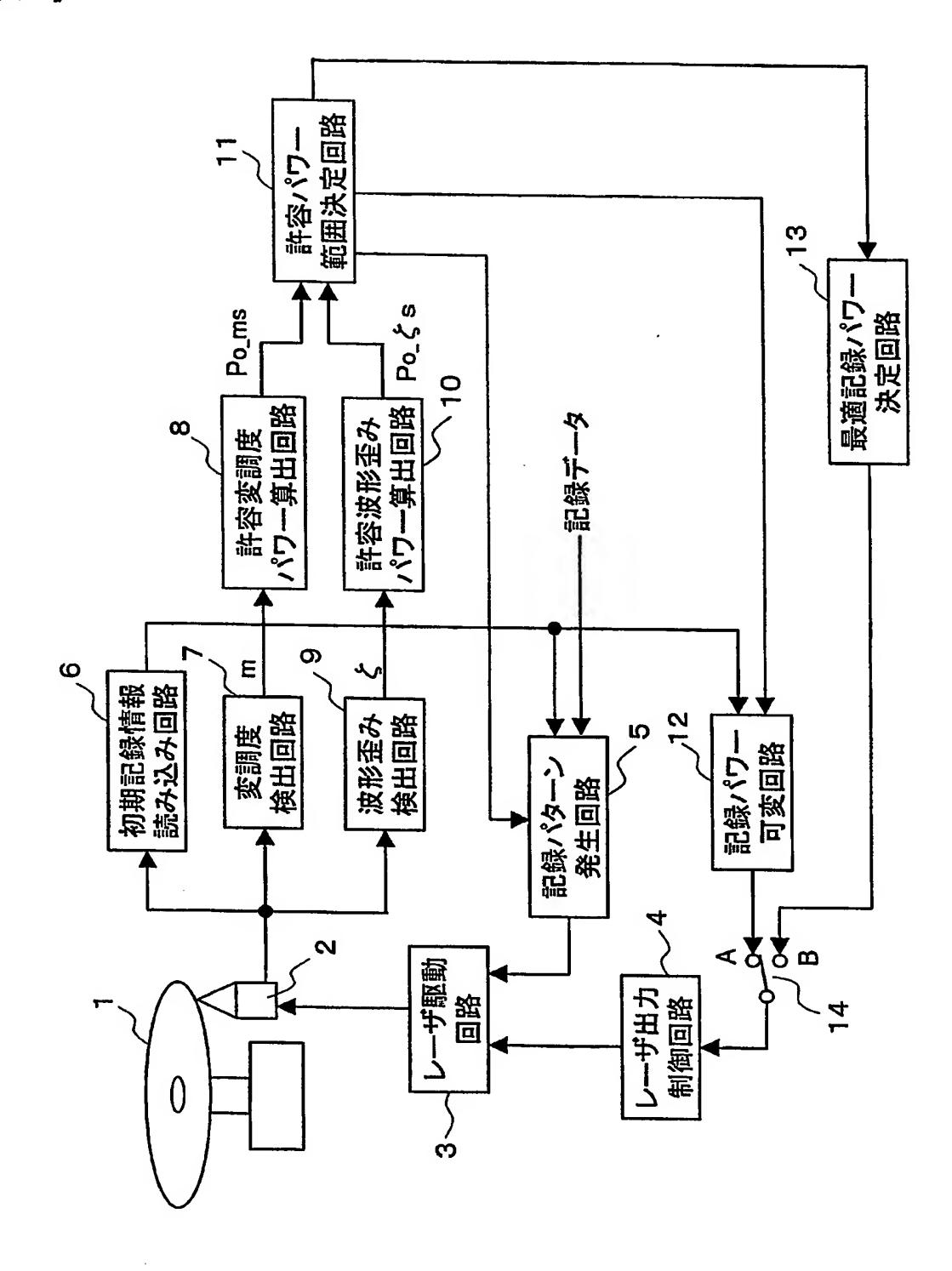
- 8 許容変調度パワー算出回路
- 9 波形歪み検出回路
- 10 許容波形歪み算出回路
- 11 許容パワー範囲決定回路
- 12 記録パワー可変回路
- 13 最適記録パワー決定回路
- 14 切換スイッチ
- 110 目標波形歪みパワー算出回路
- 111 記録パワー比決定回路
- 112 中間部記録パワー可変回路



【書類名】

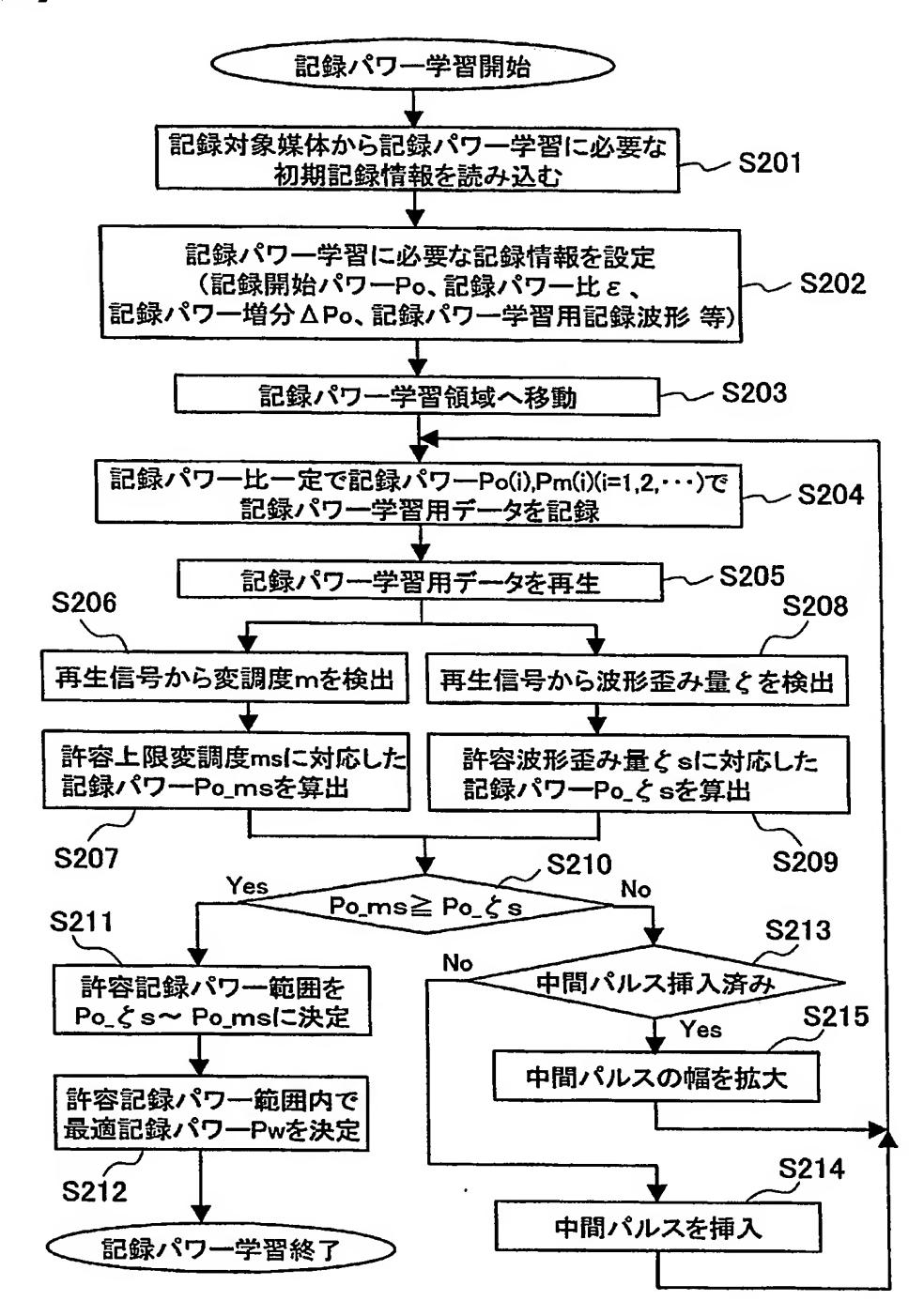
図面

# 【図1】



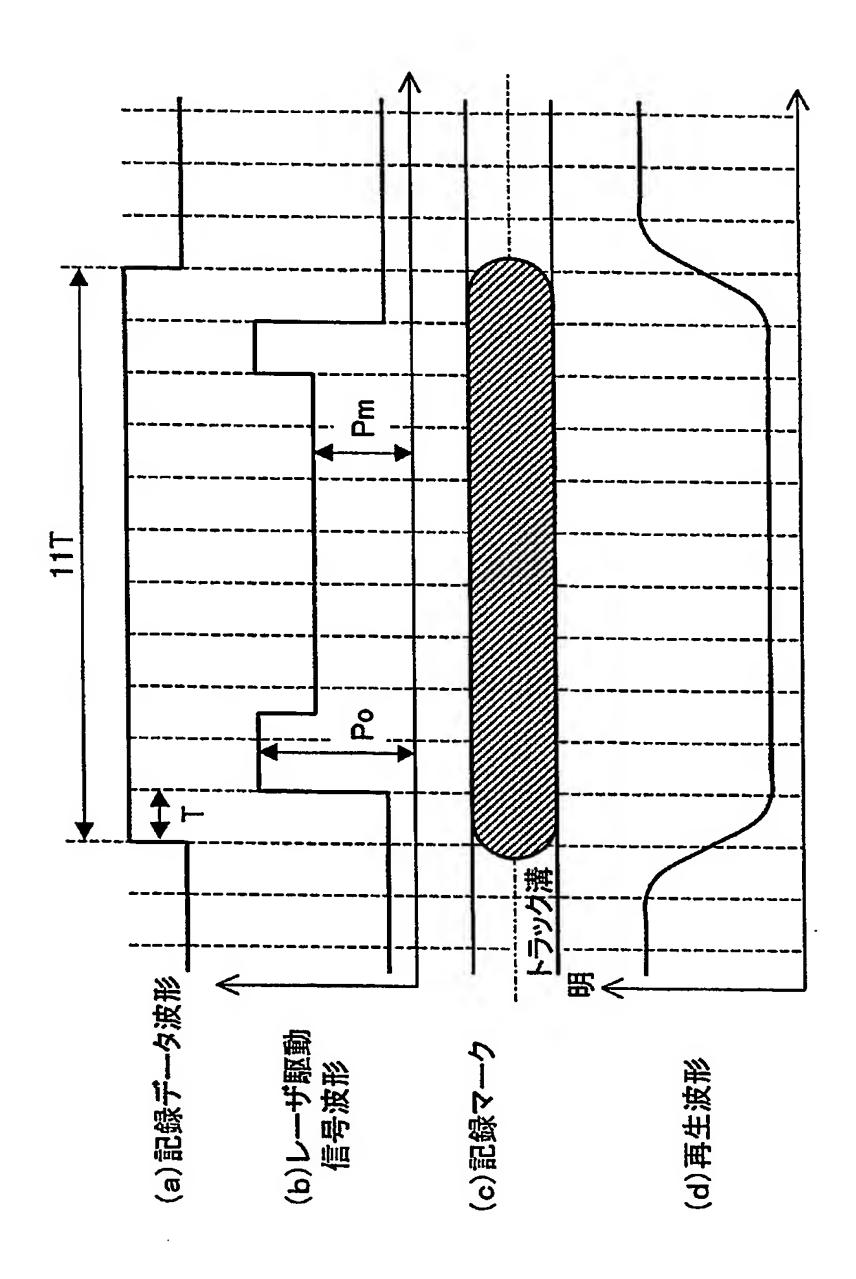


【図2】



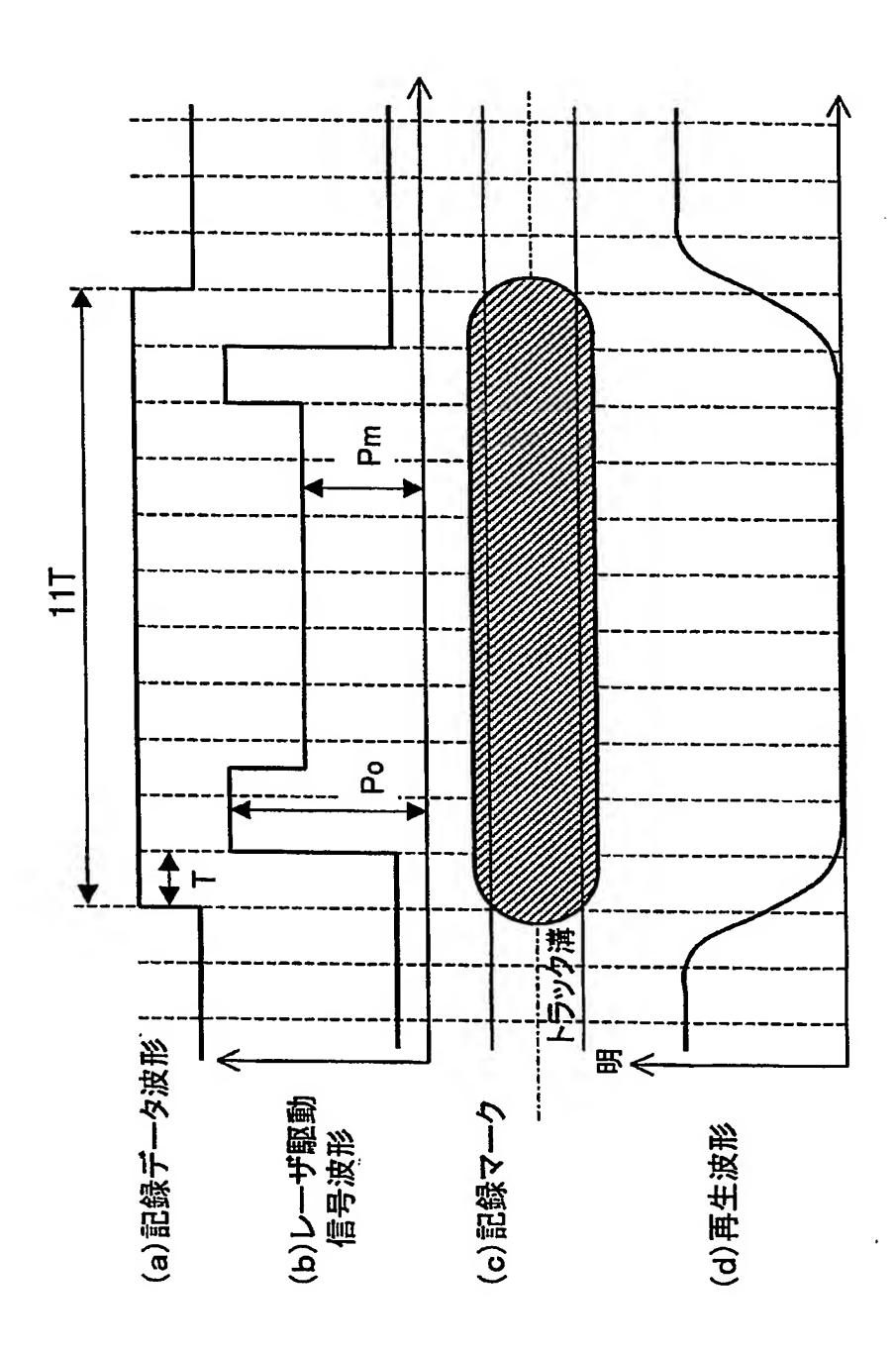


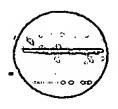
【図3】



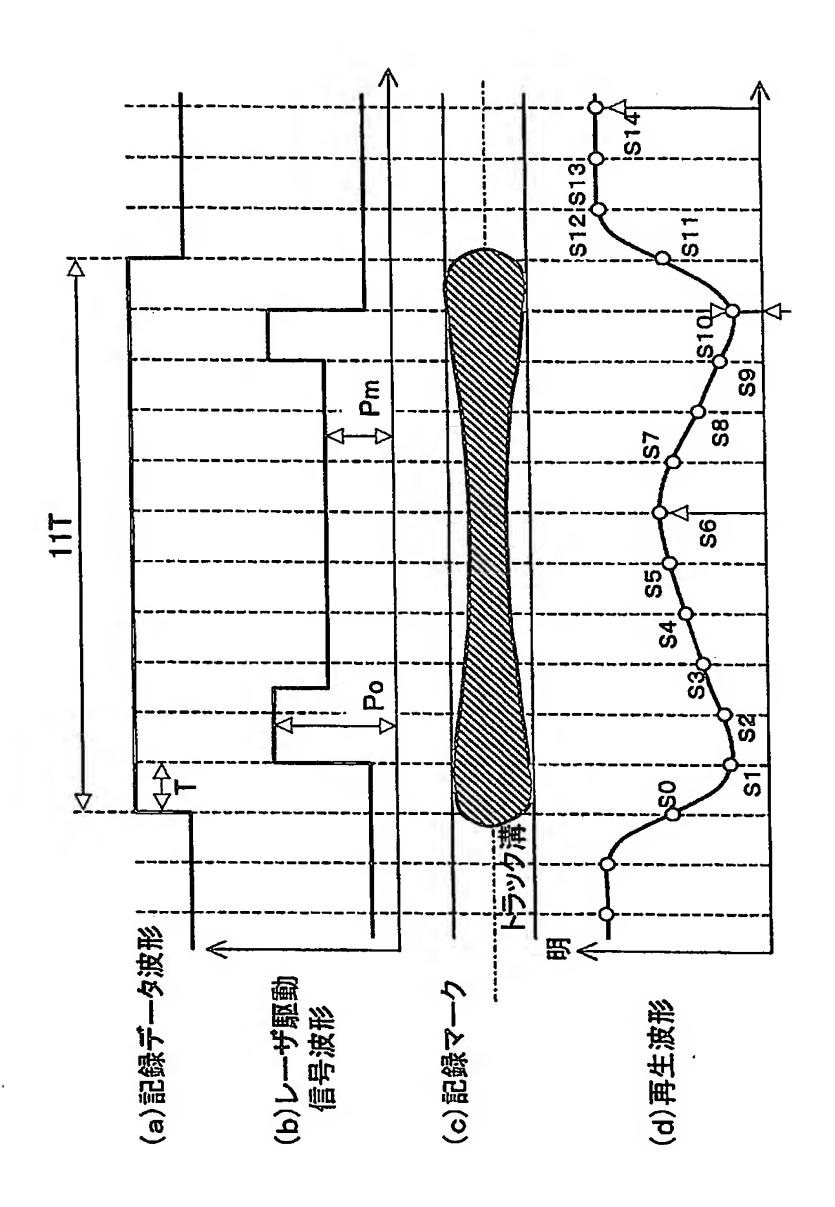


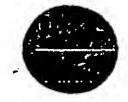
【図4】



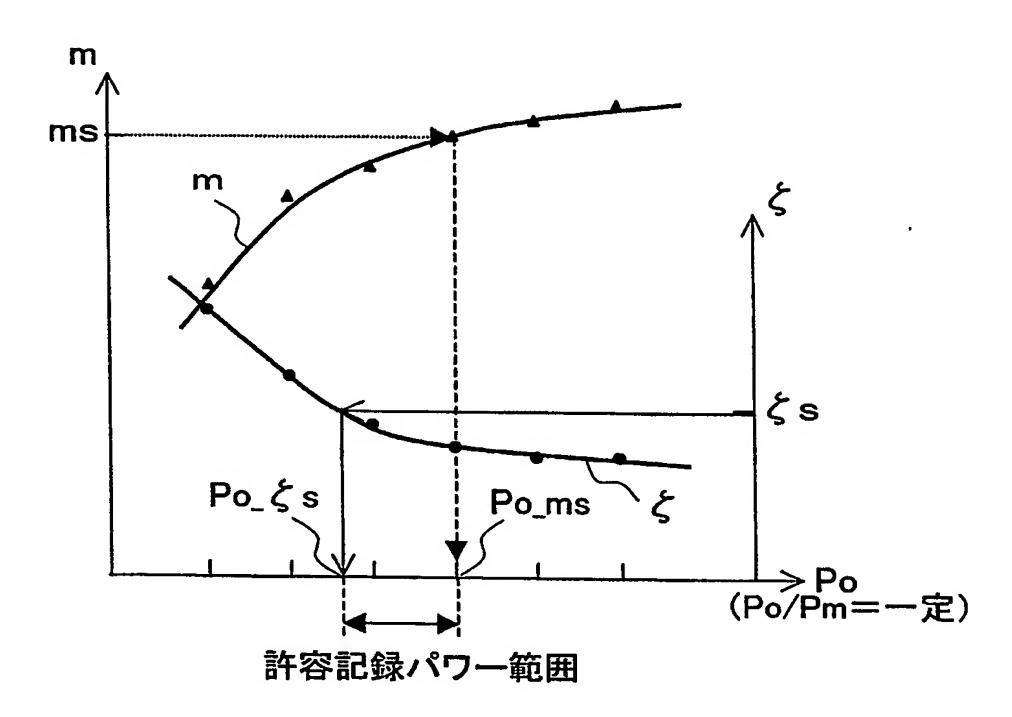


[図5]

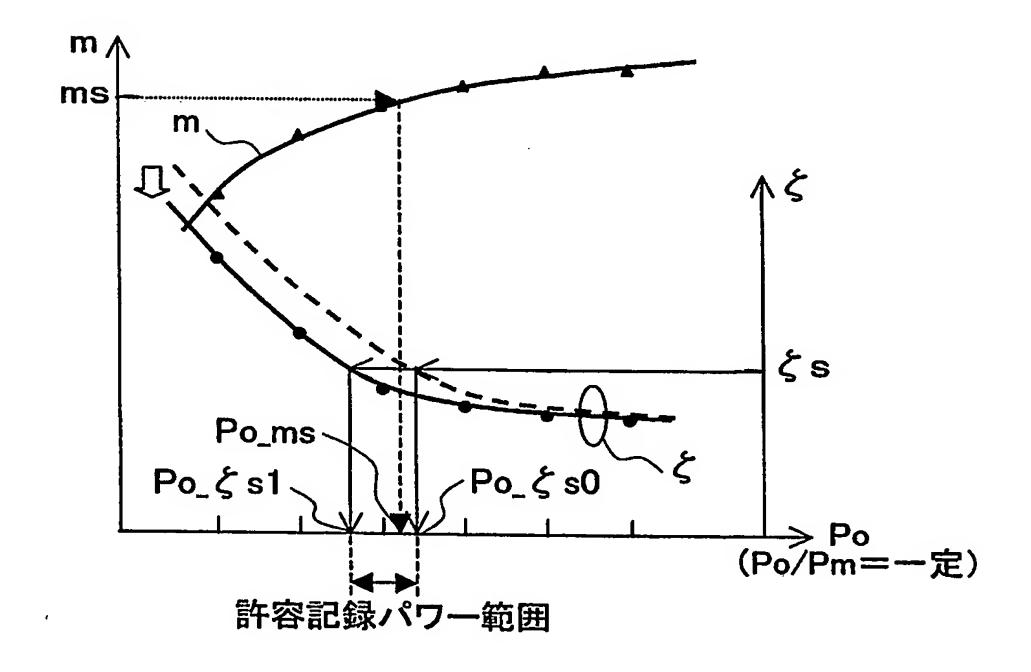




【図6】

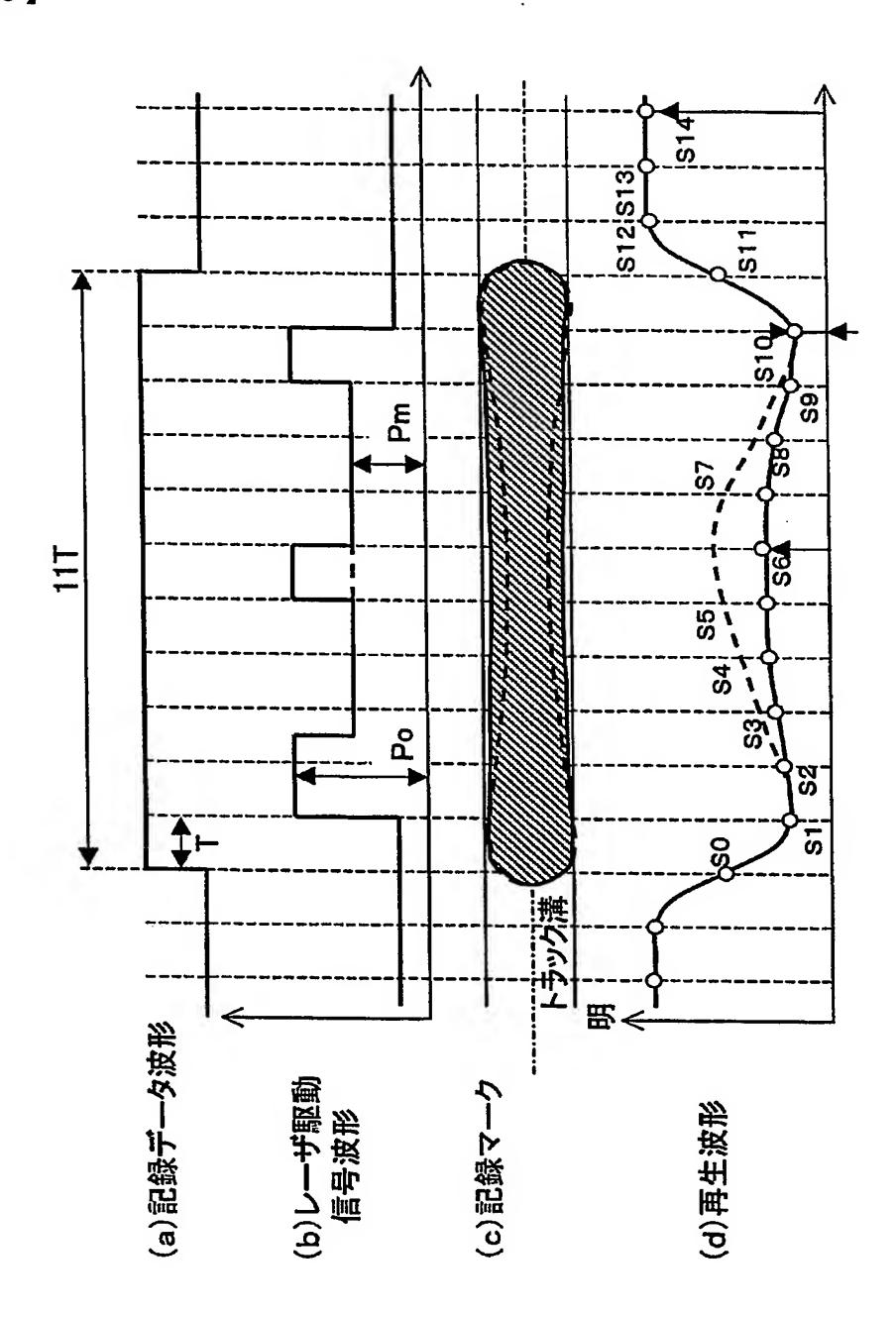


# 【図7】



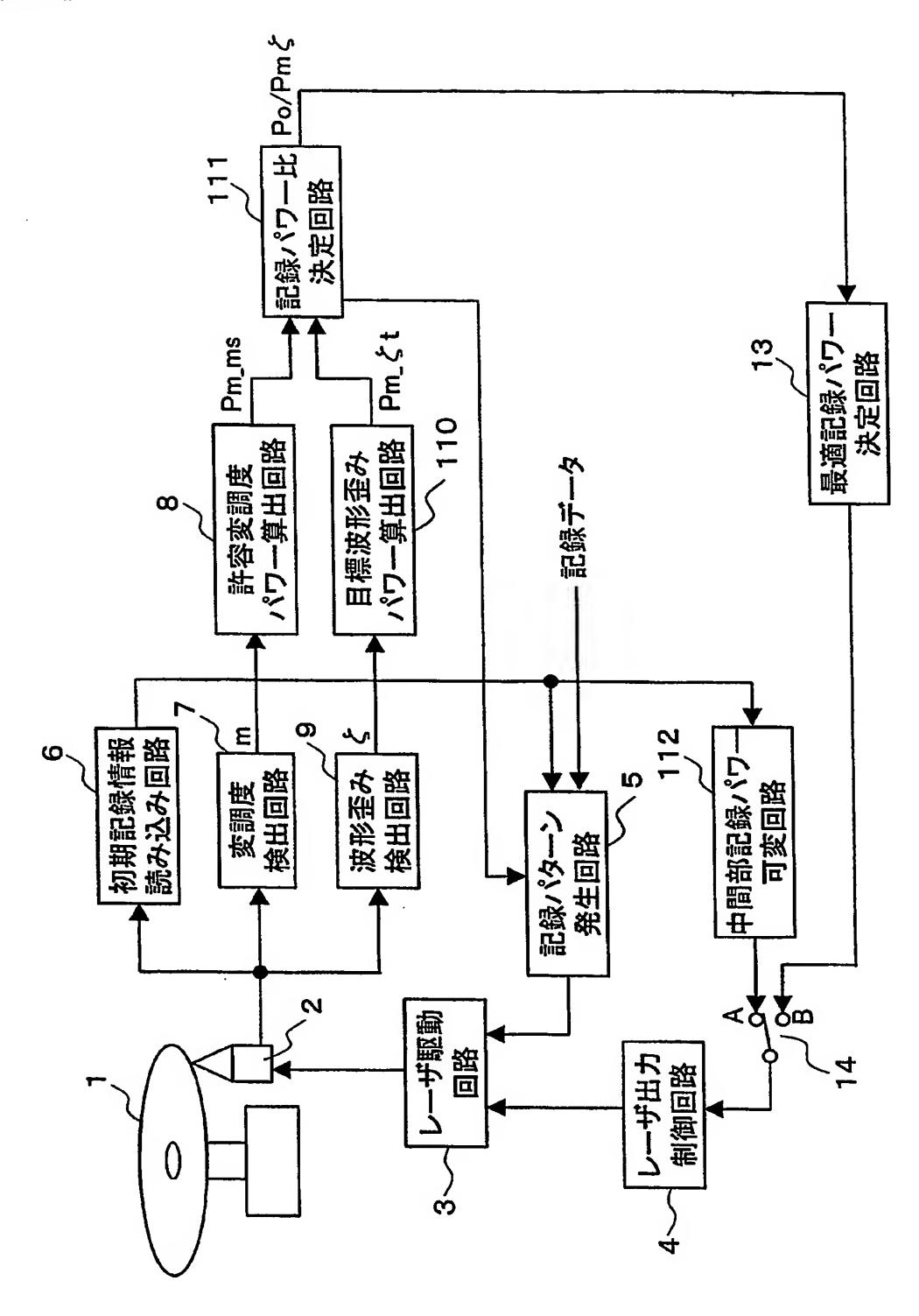


【図8】



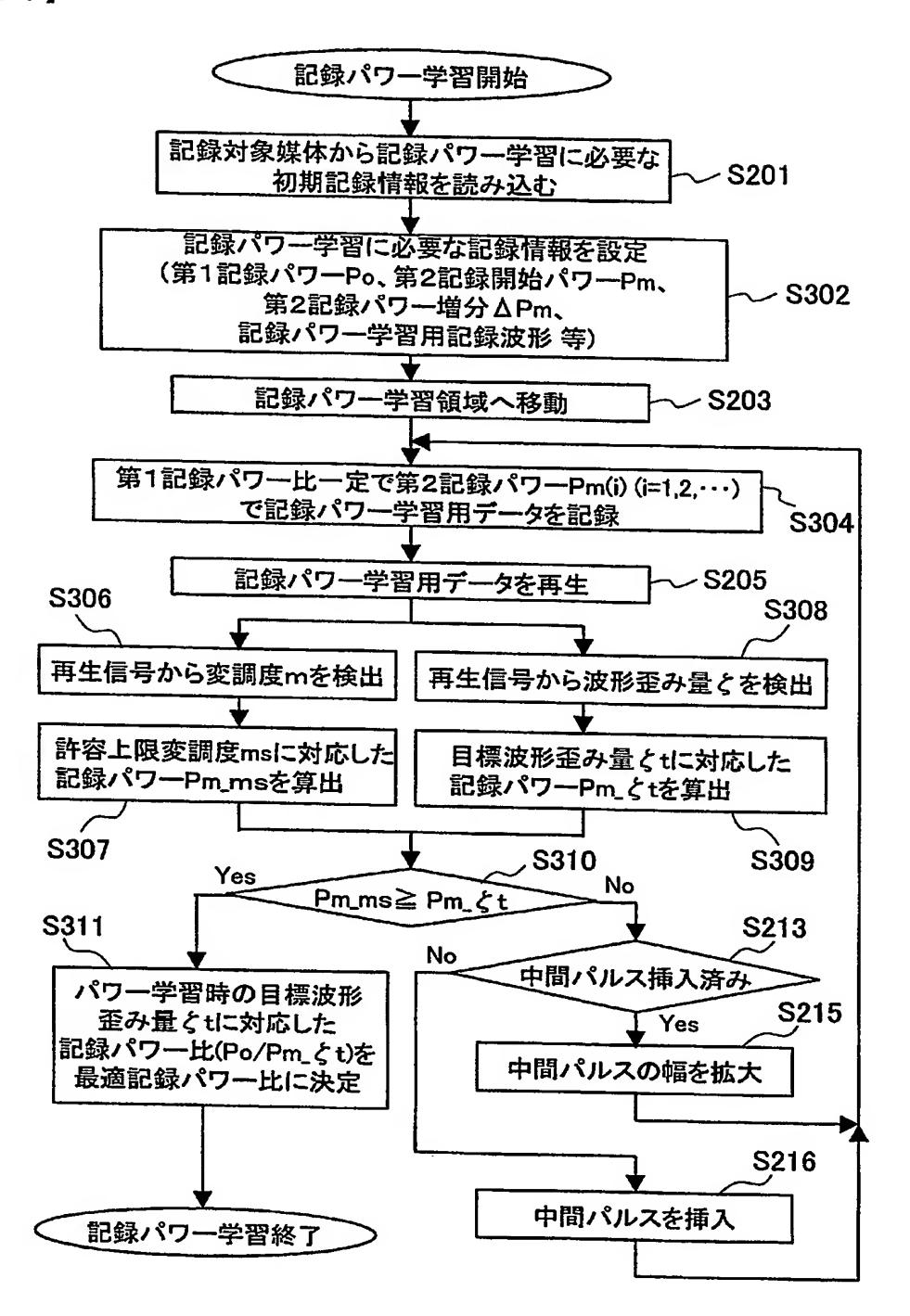


[図9]



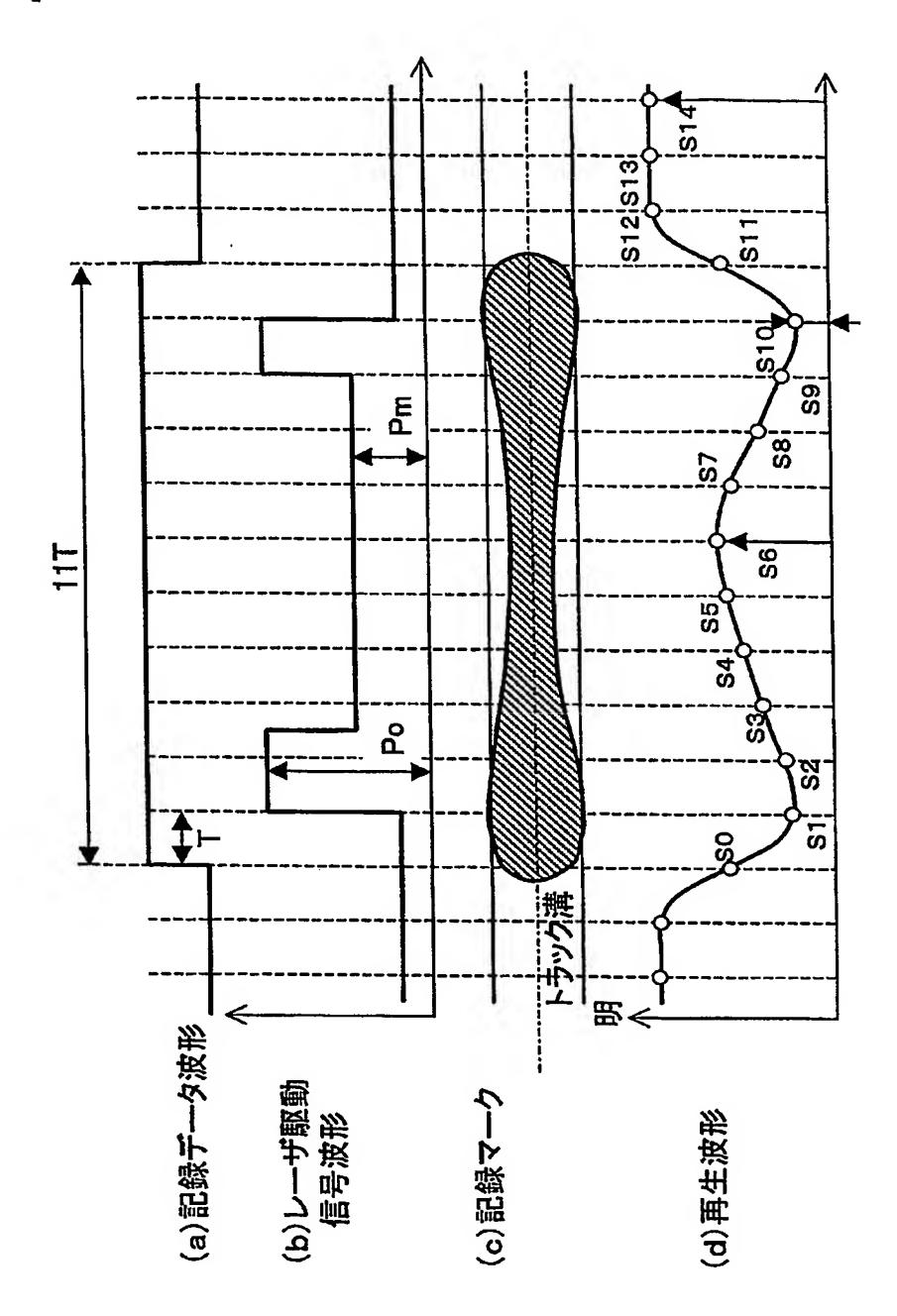


【図10】



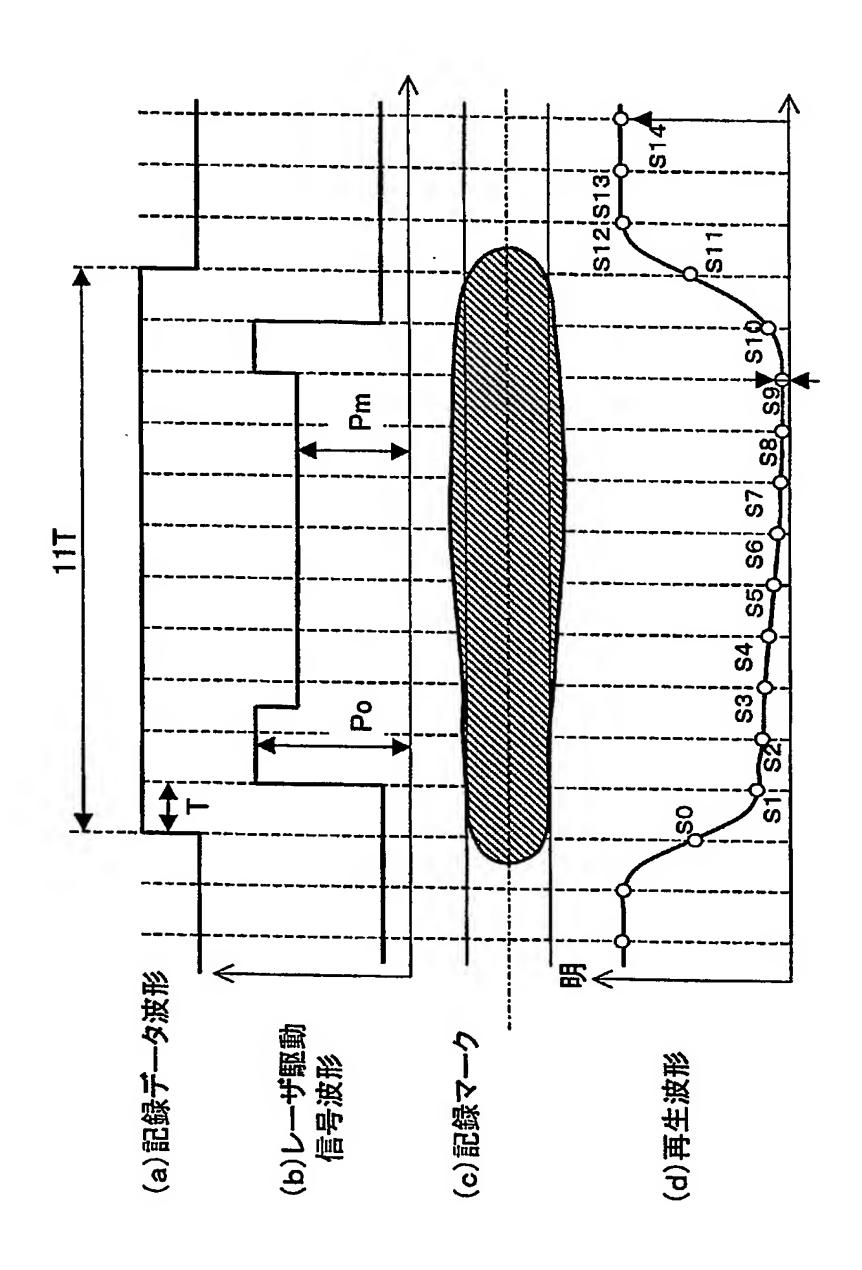


【図11】



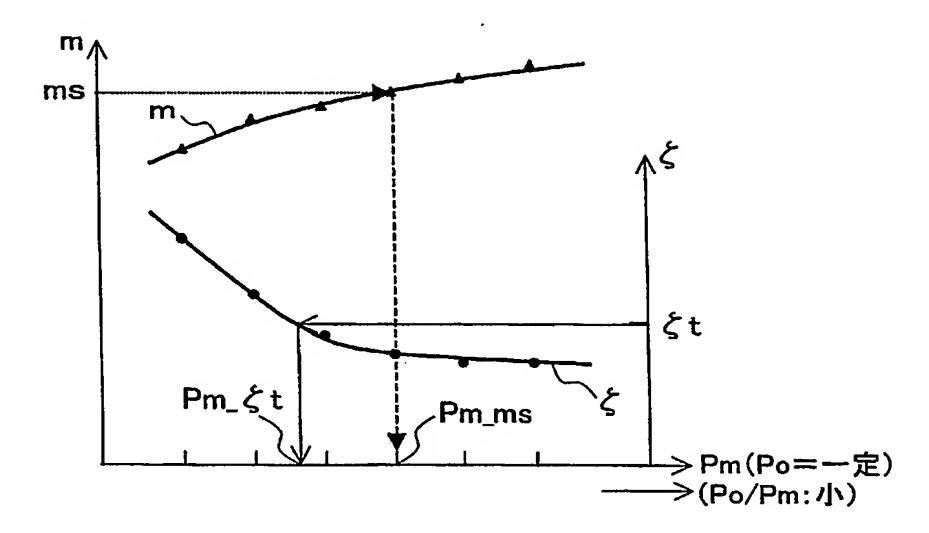


[図12]

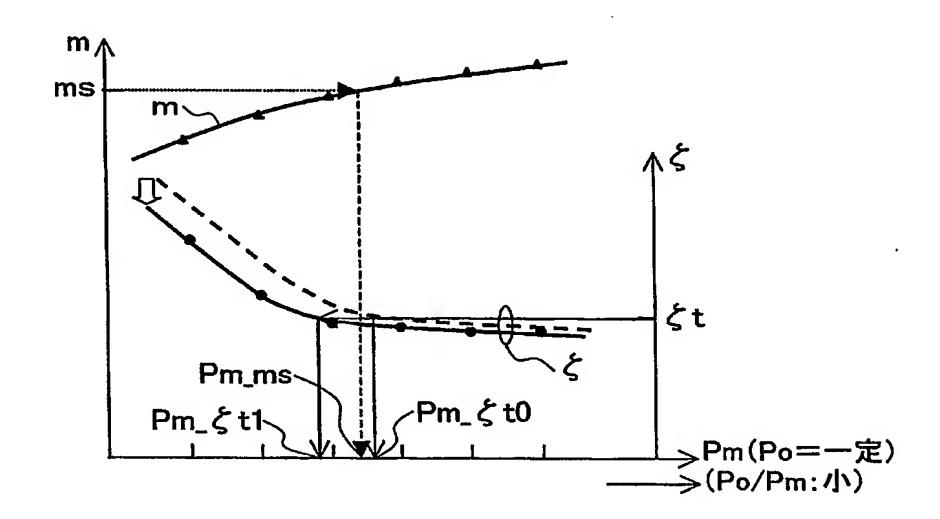




【図13】

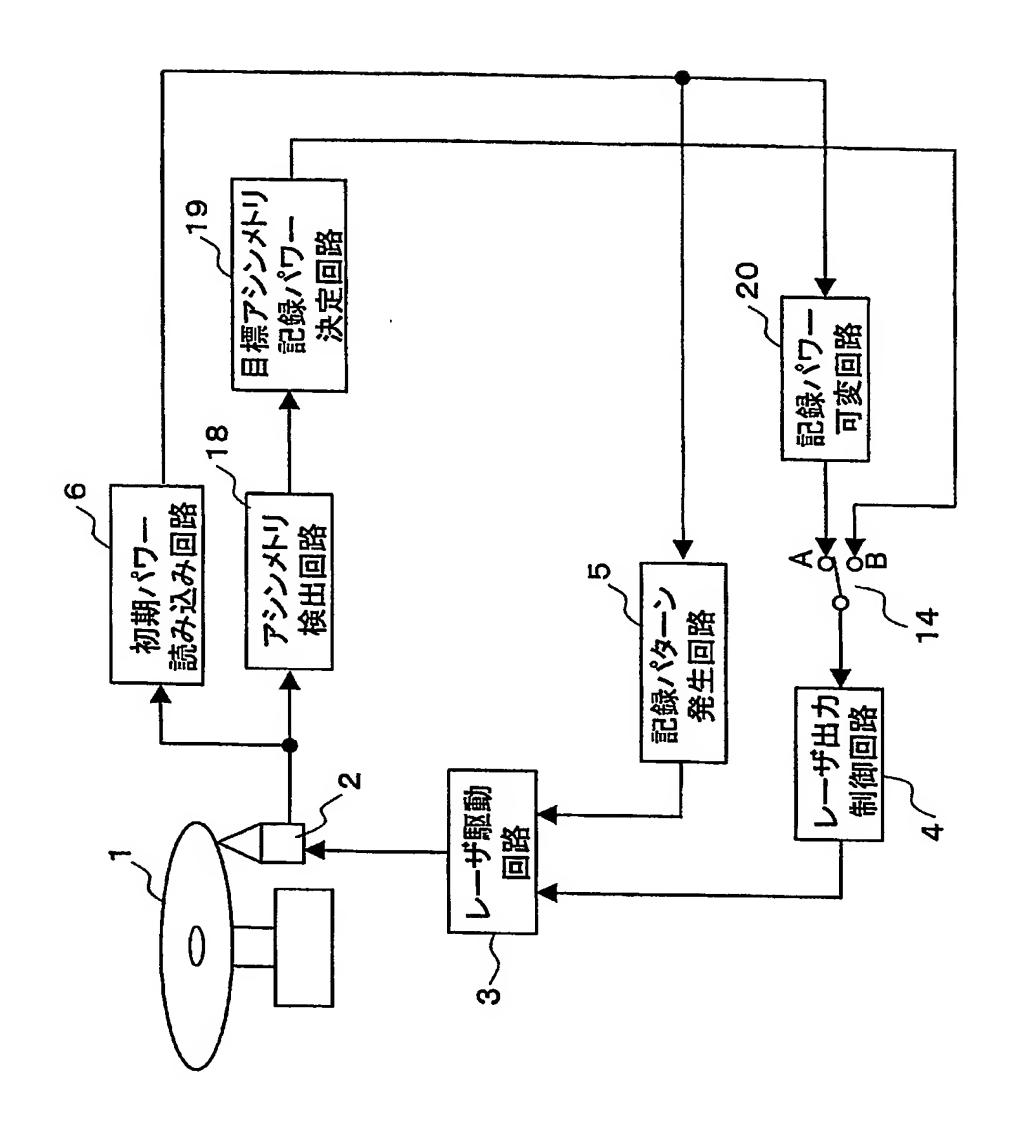


【図14】



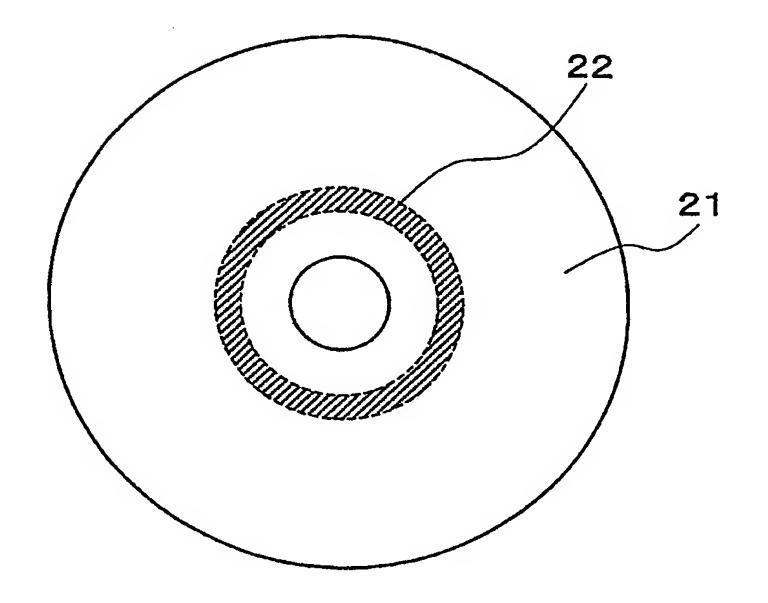


【図15】

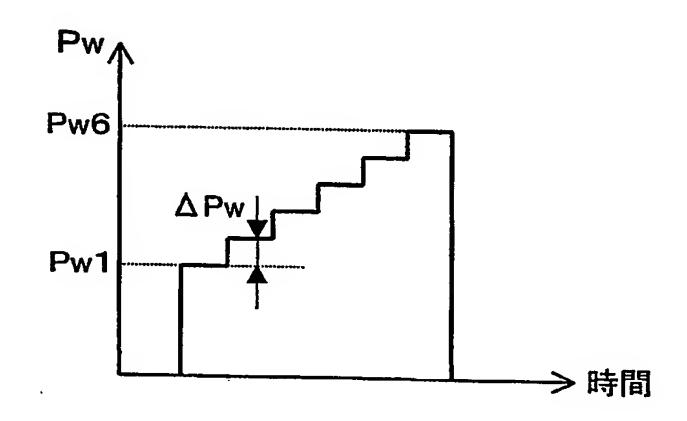




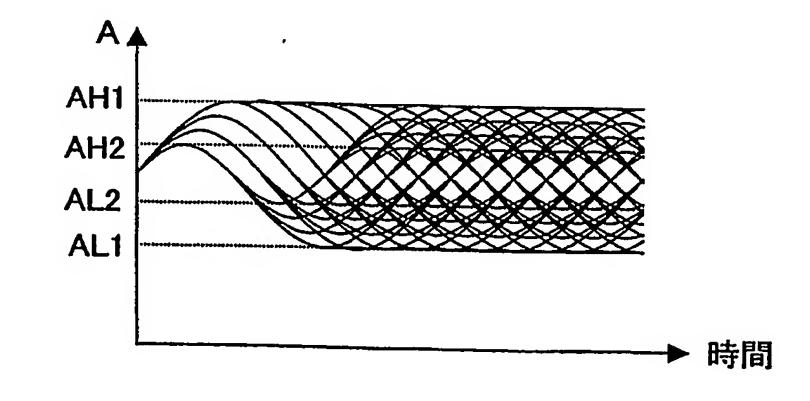
【図16】

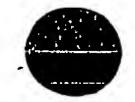


【図17】

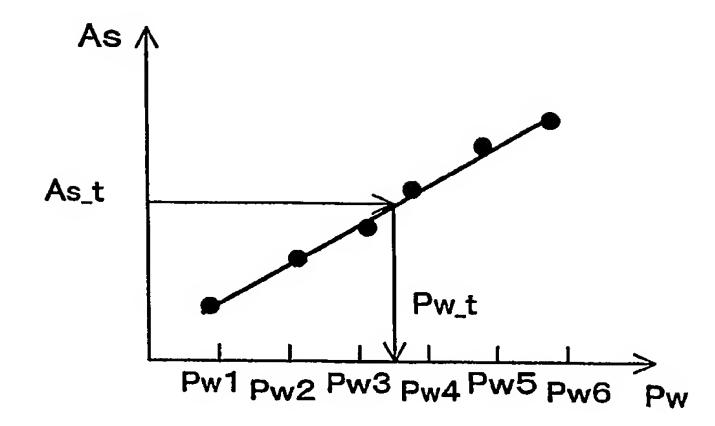


【図18】

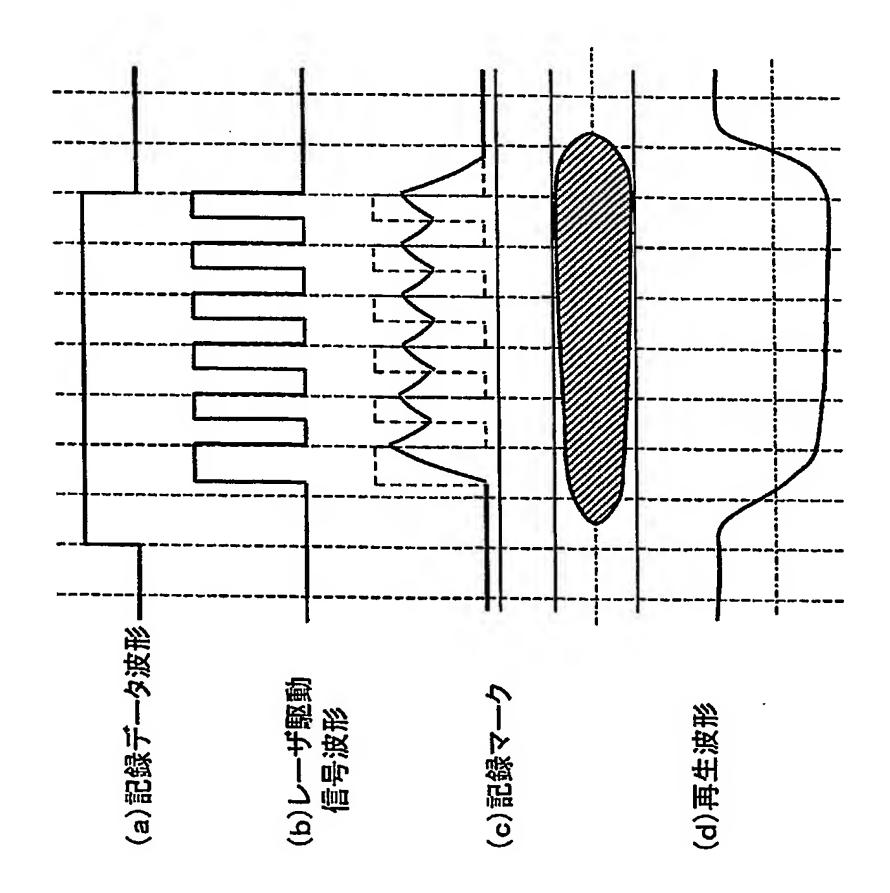


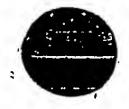


【図19】

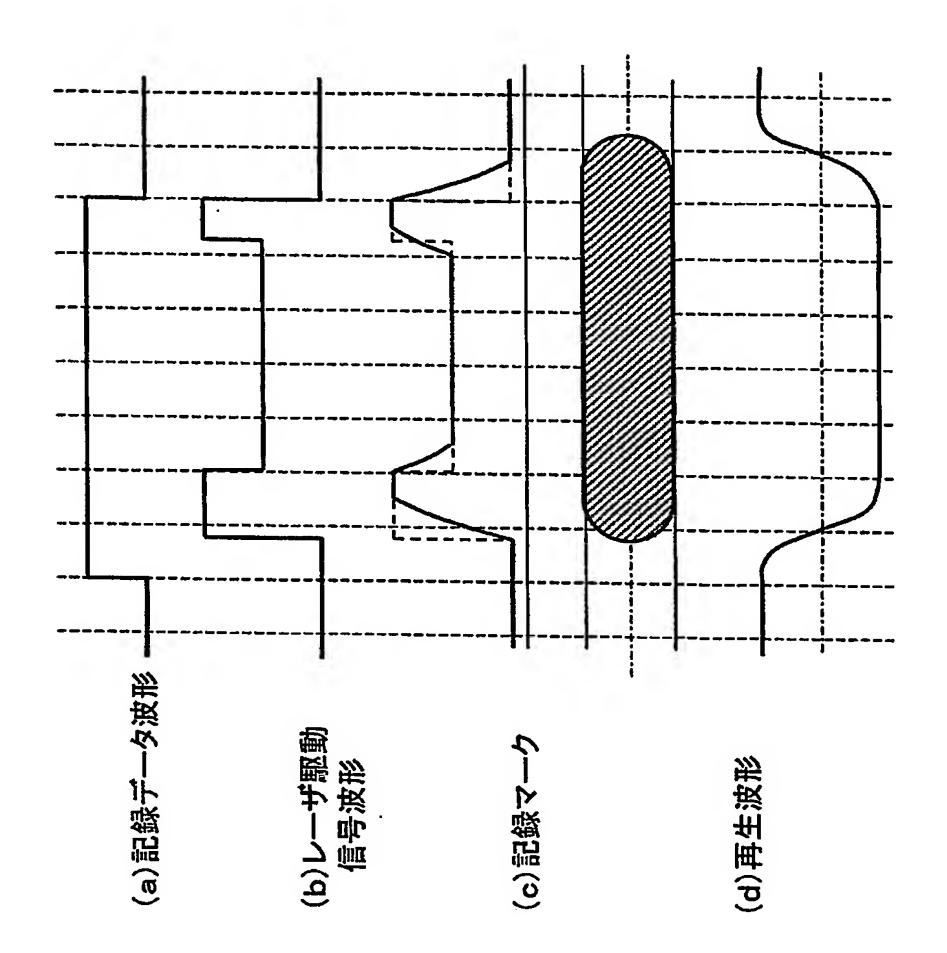


# 【図20】





【図21】





### 【書類名】 要約書

### 【要約】

【課題】 記録パワーが過大にならず波形歪みを低減した最適記録条件を決定できる記録パワー学習を行う光学的情報記録再生装置を提供する。

【解決手段】 記録パワー可変回路12が、記録パターン発生回路12から出力されるパワー学習用記録パターンの前端部および後端部での記録パワーPoと中間部での記録パワーPmとの比を一定にし、記録パワーPo、Pmを可変設定して、記録パワー学習用データが記録される。記録パワー学習用データの再生時に、許容パワー範囲決定回路11が、再生信号から検出された変調度と許容上限変調度からパワー算出回路8により算出された記録パワーを上限値、再生信号から検出された波形歪み量と許容波形歪み量から許容波形歪みパワー算出回路10により算出された記録パワーを下限値として、記録パワーの許容範囲を決定する

#### 【選択図》 図1

0



特願2003-181496

### 出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社